518, 194 16 DEC 2004

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003年12月24日(24.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/106740 A1

(51) 国際特許分類7:

PCT/JP03/07537

(21) 国際出願番号:

(22) 国際出願日:

2003年6月13日(13.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

C25D 21/00

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-175948 2002年6月17日(17.06.2002) JP 特願2002-175949 2002年6月17日(17.06.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式 会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 Tokyo (JP). 東洋メタライジング株式会社 (TOYO METALLIZ-ING CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒103-0021 東京都 中央区 日 本橋本石町3丁目3番16号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

- 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野村 文保 (NOMURA, Fumiyasu) [JP/JP]; 〒520-0867 滋賀県 大津市 大平1丁目27番5号 Shiga (JP). 原田 裕史 (HARADA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒962-0859 福島県 須賀川 市 塚田 1 丁目 1番 カトルセゾン302号 Fukushima (JP).
- (74) 代理人: 岩見 知典 (IWAMI, Tomonori); 〒520-8558 滋 賀県 大津市 園山1丁目1番1号 東レ株式会社 知的 財産部内 Shiga (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

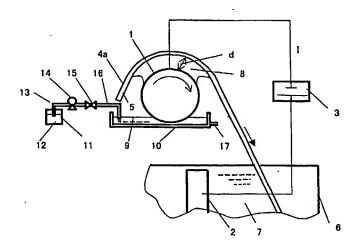
添付公開書類:

国際調査報告書

/続葉有/

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING PLATED FILM, CATHODE ROLL FOR PLATING, AND METHOD FOR MANUFACTURING CIRCUIT BOARD

(54) 発明の名称: めっき被膜付きフィルムの製造方法、めっき用 陰極ロール、ならびに、回路基板の製造方法



(57) Abstract: A method for manufacturing a plated film by bringing a film having a conductive surface into electrical contact with a cathode roll with a liquid film interposed between the film and the cathode and forming a metal plating on the conductive surface of the film, characterized in that the relation $E_0 > [(I/C_s) \times d]/\sigma$ where E_0 is the reduction potential of the metal forming the plating, I is the value of the current flowing through the cathode roll for plating. Cs is the area of the conductive surface of the film in electrical contact with the cathode roll with a liquid film interposed therebetween, d is the thickness of the gap between the cathode roll and the conductive film, and σ is the conductivity of the liquid forming the liquid film present in the gap. A cathode roll having a surface roughness Rmax of 1 μ m or less is also disclosed. Further a cathode roll having a Vickers hardness of the surface of 200 or more is disclosed.





2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

導電面を有するフィルムを液膜を介して陰極ロールに電気的に接触させて金属のめっき被膜を導電面に形成するめっき被膜付きフィルムの製造方法において、めっき被膜を形成する金属の還元電位を E_0 、めっきのために陰極ロールに流す電流値をI、陰極ロールに液膜を介して電気的に接触しているフィルムの導電面の面積を C_s 、陰極ロールとフィルムの導電面との隙間の厚さをd、および、隙間に存在する液膜を形成している液の導電率を σ_0 とするとき、 $E_0>[(I/C_s)]\times d]/\sigma_0$ なる関係が満足されていることを特徴とするめっき被膜付きフィルムの製造方法。表面の粗さ R_m_a xが、 1_{μ_m} 以下であるめっき用陰極ロール。表面のビッカース硬度が、200以上であるめっき用陰極ロール。

明細書

めっき被膜付きフィルムの製造方法、めっき用陰極ロール、ならびに、 回路基板の製造方法

5

10

15

20

25

技術分野

本発明は、めっき被膜付きフィルムの製造方法、めっき用陰極ロール、ならびに、回路基板の製造方法に関する。

本発明は、導電面を有するフィルムを搬送するフィルム搬送手段と、陰極ロールと、該陰極ロールの前または/および後に配置され、めっき液および陽極が収容されためっき浴とを用い、前記フィルムを前記フィルム搬送手段により搬送しながら、前記フィルムの導電面を液膜を介して前記陰極ロールに電気的に接触させるとともに前記めっき浴中を通過させ、前記フィルムの導電面にめっき被膜を形成してなるめっき被膜付きフィルムの製造方法の改良に関する。また、本発明は、前記陰極ロールの改良に関する。また、東に、本発明は、前記めっき被膜付きフィルムの製造方法により製造されためっき被膜付きフィルムに回路パターンを形成することにより回路基板を製造する回路基板の製造方法に関する。

本発明は、めっき被膜付き樹脂フィルムの製造に好ましく用いられる。本発明は、表面特性の良好なめっき被膜付きフィルムの製造を可能とする。本発明により製造されるめっき被膜付きフィルムは、形成されるめっき被膜に凸状あるいは凹状の傷が実質的にないため、80μmピッチ以下の超微細回路パターンを形成することにより回路基板を製造する回路基板の製造に好ましく用いられる。

本発明は、金属蒸着により形成された金属蒸着被膜を有するフィルムの該金属蒸着被膜の上に電気めっき被膜が形成されてなる、すなわち、

金属蒸着被膜とその上に形成された電気めっき被膜とからなる被膜積層を有するめっき被膜付きフィルムの製造に好ましく用いられる。

本発明は、無電解めっきにより形成された無電解めっき被膜を有するフィルムの該無電解めっき被膜の上に電気めっき被膜が形成されてなる、すなわち、無電解めっき被膜とその上に形成された電気めっき被膜とからなる被膜積層を有するめっき被膜付きフィルムの製造に好ましく用いられる。製造されたこれらのめっき被膜付きフィルムは、電子機器の部品として用いられ、部品の小型化、軽量化に寄与する。また、低コスト化を担う接着剤を使用しない2層フレキシブルプリント配線基板として好ましく用いられる。この2層フレキシブルプリント配線基板は、半導体パッケージングにおけるTAB、COF、PGAなどで利用される。

背景技術

10

15

20

フィルムを搬送させながら連続的にフィルム面にめっき被膜を形成する方法は、JP-A-07-22473やJP-A-2001-192793に記載されている。この方法は、非金属フィルムの表面に設けられている導電面を、あるいは、金属フィルムを、陰極ロールに接触させるとともに、その前または後に配置され、かつ、めっき液および陽極が収容されためっき浴中を通過させるようにフィルムを搬送し、めっき浴において、めっき被膜を前記導電面に形成するものである。この方法において、陰極ロールとめっき浴とからなるめっきユニットを複数設け、これらの複数のめっきユニットにフィルムを搬送させながら順次通過させることにより、フィルムの導電面上に、所望の厚さのめっき被膜を形成することが出来る。

25 フレキシブル回路用基板が、電子機器、電子部品、半導体パッケージ などで利用されている。この基板には、ポリイミドフィルムあるいはポ

15

20

25

リエステルフィルムと銅箔とからなる配線基板が用いられる。この配線 基板として、フィルムに接着剤を介して銅箔が貼着された、通称「3層型」と呼ばれる基板と、フィルムに、接着剤を用いることなく、金属被膜がめっきなどで形成された、通称「2層型」と呼ばれる基板とがある。 昨今の回路の配線ピッチの微細化が進む中、これらの基板の内、後者の

2層型の基板の方が、より注目されている。

3層型プリント回路用基板は、接着剤にエポキシ系樹脂あるいはアクリル系樹脂が用いられている。この基板は、接着剤に含まれる不純物イオンにより、電気特性が劣化するという欠点を有している。この基板は、接着剤の耐熱温度が100℃乃至150℃であるため、ベースフィルムにポリイミドフイルムを用いている場合、このフィルムの300℃以上の高耐熱性が十分に生かされないという欠点を有している。このため、高温実装を必要とするICチップへのワイヤーボンディングにおいては、使用する加熱温度を低下させざるを得ないという状況が発生する。

3層型プリント回路用基板では、銅箔の一般的な膜厚が 18μ mあるいは 35μ mである。そのため、 80μ mピッチ (銅配線幅: 40μ m、配線間隔: 40μ m) 以下のピッチでパターンニングを行う場合、銅が厚すぎてエッチング率が著しく低下する上、銅箔の表面側の回路幅と接着剤面側の回路幅とが著しく異なり、あるいは、エッチングで回路幅全体が著しく細り、所望とする回路パターンが得られないという現象が発生する。

上記の3層型における問題点を解決するために、接着剤を使用しない2層型プリント回路用基板が提案されている。2層型基板は、各種蒸着法、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、あるいは、各種イオンプレーティング法(PVD法、金属を含む薬品を気化させ蒸着させるCVD法など)により、フィルム上に各種金属を蒸着し導電面を形成した後

15

20

25

に、または、無電解めっき法により、フィルム上に各種金属をめっきし 導電面を形成した後に、該導電面を電解銅めっきすることにより製造される。

2層型基板は、電解銅めっきで、銅膜厚を自由に変化させることが出来る。例えば、 8μ mの銅膜厚が得られれば、 60μ mピッチの回路パターンが簡単に作成出来るようになり、かつ、各種ベースフィルムの耐熱温度特性を十分に利用することが出来るようになる。この様な状況から、めっき被膜付きフィルムの需要が高まりつつある。

しかし、連続的に搬送されるフィルムにめっきを施す場合、フィルムの剛性から、搬送過程におけるフィルムに作用する張力の大きさは、それ程大きな値にすることが出来ない。

また、搬送されているフィルムと陰極ロールとの間に、ある程度の滑りがないと、フィルムの搬送状態が陰極ロールにより阻害され、フィルム幅方向の複数の個所における搬送張力のアンバランスが発生する。このアンバランスにより、搬送されているフィルムにシワや折れが発生し、フィルムの搬送状態が不安定となる。

この問題の解消は、従来の装置においては、走行フィルムが、めっき 浴からめっき液を随伴し陰極ロールに至ることにより、陰極ロール上に 形成される液膜により、図られていた。この液膜により、フィルムと陰 極ロールとの間にある程度の滑りがもたらされる。この滑りにより、フィルム幅方向の複数箇所におけるフィルムの搬送状態の不安定さが抑制 されていた。

また、JP-A-2001-192793に示されている様に、搬送フィルムが銅箔の様な金属箔であれば、フィルムの搬送張力を大きくでき、かつ、表面抵抗値も小さく、陰極ロールとの完全導通が得られ、問題は生じなかった。

15

20

25

しかし、JP-A-07-22473に示されている様に、厚さ50μ mのポリイミドフィルムを搬送しようとすると、フィルムのヤング率や強度などの関係から、フィルムが破断する恐れがある。また、形成されるめっき被膜に、内部応力が発生する恐れがある。従って、フィルムに大きな張力を付与することが出来ず、比較的低いフィルム張力下でフィルムの搬送状態をバランスさせながら、めっき被膜を形成する方法が採用されている。つまり、陰極ロールとフィルムの導電面との間に、ある程度のめっき液を含む液膜を介在させることで、陰極ロールとフィルムを間に適度な滑りを生じさせ、フィルムの搬送の安定化を図っていた。

しかしながら、この方法においても、めっき被膜を形成するために陰極ロールから電流を流すと、しばしば、陰極ロールに、めっき被膜を形成する金属が析出し、付着することがある。

陰極ロールに付着した金属がフィルムに持って行かれて、めっき浴中で、これを核にして、電界集中により、導電面あるいはめっき被膜面に異常突起(凸型欠陥)を形成する現象が見られる。また、陰極ロールに付着した金属により、フィルムが凹み、あるいは、導電面あるいはめっき被膜面に傷をつける現象が見られる。その後に更に形成されるめっき被膜の膜厚は、この凹みや傷部分を平坦化するには十分でない。その結果、製造されるめっき被膜付きフィルムの表面は、凹型欠陥を有することになる。更に、陰極ロールに付着した金属の形状がフィルムの導電面に転写され、表面品位を悪化させる問題もある。

めっき被膜付きフィルムの表面に形成された凸状や凹状の欠陥は、回路配線を作る際のエッチング工程や、回路実装工程のICチップなどのボンディング工程において、断線などの不具合を発生させるおそれがあり、回路の品質保証が出来なくなるという問題を招く。

25

この問題を引き起こす陰極ロールへのめっき被膜を形成する金属の析 出を抑制する方法は未だ見つかっていない。現状では、しばらく装置を 運転した後、生産を止めて、陰極ロールに析出し付着している金属を削 り取り、その後に、装置の運転を再開することが行なわれている。この 陰極ロールからの金属除去は、めっき被膜付きフィルムの生産性を著し く低下させる原因となっている。

一方、従来の陰極ロールは、Fe系材料で形成されている。また、めっき液は、硫酸を主体とした液であり、その中に塩酸が配合されていることが多かった。従って、陰極ロールは、腐食対策のための材料選択が難しいという問題を有していた。この状況の中、めっき液に耐性のある材料として、SUS316が好適に用いられてきた。しかし、このSUS316であっても、しばらく使用していると、粒界腐蝕を起こす問題を有していた。

陰極ロールは、フィルムを搬送するロールとしての役割もある。陰極ロールは、走行フィルムによる擦れが発生し、徐々にキズがつくという問題があった。従って、しばらく生産に使用していると、陰極ロールが傷つき、この傷により、フィルムとの摩擦力が増し、フィルムをグリップする状態が発生する。この状態は、フィルムに張りや撓みを発生させ、フィルムの搬送に蛇行をもたらし、フィルムにシワの発生をもたらす。ひどい場合には、走行フィルムに折れシワを形成する。

また、場合によっては、陰極ロールに、めっき被膜を形成する金属、例えば、銅が析出し、付着することがある。この付着物を除去しようとして、研磨材入りのスポンジで付着物、例えば、銅を掻き取る作業を行なうと、この作業に伴い、陰極ロールを形成している材料であるSUS316をも傷をつけてしまうことがしばしばあった。

この傷の形状は、製造されためっき被膜付きフィルムのめっき被膜、

15

20

例えば、銅被膜に転写される。この転写された傷を有するめっき被膜付きフィルムは、いわゆるヘアーラインという表面品位欠陥を有する。このヘアーラインは、凹み状の傷であり、回路配線をつくる際のエッチング工程や、回路実装工程におけるICチップなどのボンディング工程における断線の発生をもたらす。その結果、製造される回路の品質保証ができなくなる恐れがあった。

また、めっき用陰極ロールの傷による消耗が激しく、連続生産している場合には、2週間から約1ヶ月で、めっき用陰極ロールを、再研磨するために、交換する必要があった。これは、装置の維持費用の大きな増加をもたらし、メンテナンス作業の増大をもたらし、生産性の低下と生産コストの上昇の要因となっていた。

この問題を解決するために、JP-3135176には、フレキシブル回路基板の製品になるめっき被膜面、例えば、銅面に、陰極ロールを接触させない方式が提案されている。この方式は、いわゆる非接触搬送方式であり、現在、めっき被膜付きフィルムの製造に使用されている。この方式の概略は、第17図に示される。第17図において、搬送ロール52、53は、それらの両側部分に、大径のディスク52a、52b、53a、53bを有する。フィルム50の両側部分51a、51bがこれらのディスクによりガイドされることにより、フィルム50が搬送される。第17図において、記号Wはフィルム50の全幅、記号Waは、非接触分の幅を示す。フィルム50の搬送時には、搬送ロール53の内側から外側に向かって液体を流して、フィルム50を外側に付勢する力を作用させている。液体は、液体源55から流量調整ユニット56を介して供給され、ノズル管57の各ノズル孔58から噴出される。

25 しかしながら、この方式でフィルム 5 0 を搬送すると、ロール内側から付勢力を働かせている液体が不安定になり、搬送ロール大径部分(デ

15

20

25

ィスク部分)からフィルム 5 0 が外れ、連続生産を行うことが出来なかった。また、この搬送ロール 5 3 が陰極ロールである場合には、両側からの給電では給電面積が小さく、給電が不安定になりやすい。その結果、形成されるめっき被膜の厚さにムラが発生した。めっき用陰極ロールの消耗が激しく、連続生産している場合には、2週間から約1ヶ月で、めっき用陰極ロールを、再研磨するために、交換する必要があった。これは、装置の維持費用の大きな増加をもたらし、メンテナンス作業の増大をもたらし、生産性の低下と生産コストの上昇の要因となっていた。

電気・電子機器のIC化および高密度・高集積化が急速に進んでいる。

それに伴い、フレキシブルプリント回路基板のパターンのピッチは、150 乃至 200 μ mピッチから 80 乃至 150 μ mピッチへとファインピッチ化が進み、現在、30 乃至 80 μ mピッチを有するパターンの作成の要求が出てきている。将来において、80 μ mピッチ未満のピッチを有するパターンの作成の要求が出てくることが予想される。

本発明は、上述の従来技術の問題点を解決し、上述の要求に答えることが可能なめっき被膜付きフィルムの製造方法を提供することを目的とする。

本発明は、上述の従来技術の問題点を解決し、上述の要求に答えることが可能なめっき被膜付きフィルムの製造方法において使用されるめっき用陰極ロールを提供することを目的とする。

発明の開示

本発明のめっき被膜付きフィルムの製造方法は、導電面を有するフィルムを搬送するフィルム搬送手段と、陰極ロールと、該陰極ロールの前または/および後に配置され、めっき液および陽極が収容されためっき浴とを用い、前記フィルムを前記フィルム搬送手段により搬送しながら、

前記フィルムの導電面を液膜を介して前記陰極ロールに電気的に接触させるとともに前記めっき浴中を通過させ、前記フィルムの導電面にめっき被膜を形成してなるめっき被膜付きフィルムの製造方法において、前記めっき被膜を形成する金属の還元電位を E_0 、めっきのために前記陰極ロールに流す電流値をI、前記陰極ロールに前記液膜を介して電気的に接触している前記フィルムの導電面の面積を C_s 、前記陰極ロールと前記フィルムの導電面との隙間の厚さをd、および、該隙間に存在する前記液膜を形成している液の導電率を σ とするとき、

 $E_0 > [(I/Cs) \times d]/\sigma$

10 なる関係が満足されていることを特徴とする。

前記隙間に存在する前記液膜を形成している液の導電率が、硫酸を主体とする電解液の濃度により制御されることが好ましい。

前記隙間に存在する前記液膜を形成している液の導電率が、1mS/cm以上100mS/cm以下であることが好ましい。

前記隙間の厚さdの値が、20μm以上500μm以下であることが 好ましい。

前記隙間の厚さdの値が、前記フィルムの搬送張力により制御されることが好ましい。

前記フィルムの搬送張力が、10N/m以上320N/m以下である 20 ことが好ましい。

前記めっき被膜が、銅であることが好ましい。

前記フィルムが、ポリイミド樹脂、あるいは、ポリエステル樹脂から なることが好ましい。

前記陰極ロールの表面に析出する前記めっき皮膜を形成する物質が、 55 前記陰極ロールの表面に接して設けられたブレードおよび/または弾性 体により除去されることが好ましい。

15

20

25

前記陰極ロール、前記プレード、および、前記弾性体の少なくとも一つに、連続的または間欠的に液体が供給されることが好ましい。

本発明のめっき用陰極ロールは、導電面を有するフィルムを搬送するフィルム搬送手段と、陰極ロールと、該陰極ロールの前または/および後に配置され、めっき液および陽極が収容されためっき浴とを用い、前記フィルムを前記フィルム搬送手段により搬送しながら、前記フィルムの導電面を液膜を介して前記陰極ロールに電気的に接触させるとともに前記めっき浴中を通過させ、前記フィルムの導電面にめっき被膜を形成してなるめっき被膜付きフィルムの製造に用いられるめっき用陰極ロールにおいて、その表面の粗さRmaxが、1μm以下であることを特徴とする。

本発明のめっき用陰極ロールは、導電面を有するフィルムを搬送するフィルム搬送手段と、陰極ロールと、該陰極ロールの前または/および後に配置され、めっき液および陽極が収容されためっき浴とを用い、前記フィルムを前記フィルム搬送手段により搬送しながら、前記フィルムの導電面を液膜を介して前記陰極ロールに電気的に接触させるとともに前記めっき浴中を通過させ、前記フィルムの導電面にめっき被膜を形成してなるめっき被膜付きフィルムの製造に用いられるめっき用陰極ロールにおいて、その表面のピッカース硬度が、200以上であることを特徴とする。

本発明のめっき用陰極ロールにおいて、タングステンを主体とする表 面層が設けられていることが好ましい。

本発明のめっき用陰極ロールにおいて、タングステンを50%以上含有し、かつ、クロム、ニッケル、および、炭素からなる群から選ばれた少なくとも一種の元素を含有する表面層が設けられていることが好ましい。

WO 03/106740 PCT/JP03/07537

本発明のめっき用陰極ロールにおいて、タングステンを60乃至80 重量%、クロムを15乃至25重量%、ニッケルを1乃至10重量%、 および、炭素を1乃至10重量%を含有する表面層が設けられているこ とが好ましい。

本発明のめっき用陰極ロールにおいて、溶射法により表面処理されていることが好ましい。

前記溶射法が、爆発溶射法であることが好ましい。

前記溶射法により表面処理され形成された溶射膜の気孔率が、2%以下であることが好ましい。

10 本発明のめっき用陰極ロールを本発明のめっき被膜付きフィルムの製造方法を実施する際の陰極ロールとして用いることにより、当該陰極ロールに対し複数列のフィルムを同時に並列して走行させることが可能となる。

本発明の回路基板の製造方法は、本発明のめっき被膜付きフィルムの 15 製造方法ににより製造されためっき被膜付きフィルムに回路パターンを 形成することを特徴とする。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施に用いられるめっき被膜付きフィルムの製造 20 装置の一態様の縦断面概略図である。

第2図は、第1図の装置における陰極ロールおよびめっき浴の一部の 縦断面概略図である。

第3図は、本発明の実施に用いられる陰極ロールユニットの一態様の 縦断面概略図である。

25 第4図は、本発明の実施に用いられる陰極ロールユニットの他の態様 の縦断面概略図である。 第5図は、実施例1における各整流器の投入電流値に対する隙間と導 電率の関係を示すグラフである。

第6図は、陰極ロールにおける液膜厚さを測定する測定装置の斜視概略図である。

5 第7図は、実施例3および4におけるフィルムの搬送位置を示す平面 図である。

第8図は、実施例3および4におけるフィルムの張力を測定する測定 測定装置の斜視概略図である。

第9図は、実施例3におけるフィルムの搬送位置を示すグラフである。

第10回は、実施例4におけるフィルムの搬送位置を示すグラフである。

第11図は、比較例3におけるフィルムの搬送位置を示すグラフである。

第12図は、比較例4におけるフィルムの搬送位置を示すグラフであ 15 る。

第13図は、実施例3におけるフィルムの張力の測定結果を示すグラフである。

第14図は、実施例4におけるフィルムの張力の測定結果を示すグラフである。

20 第15図は、比較例3におけるフィルムの張力の測定結果を示すグラフである。

第16図は、比較例4におけるフィルムの張力の測定結果を示すグラフである。

第17図は、JP-3135176に開示されている従来のフィルム 25 の非接触搬送装置の斜視図である。

15

発明を実施するための最良の形態

本発明のめっき被膜付きフィルムの製造方法の一態様が、図面の参照のもとに、説明される。

第1図には、導電面を有するフィルム4aが、フィルム搬送手段により、フィルム巻き出し手段306から連続して引き出され、搬送され、めっき浴6においてめっきされ、めっき被膜付きフィルム4bとしてフィルム巻き取り手段324により巻き取られてなる連続式の電気めっき装置の全体の概略が示される。

この装置におけるめっき被膜付きフィルム4bの製造工程は、導電面を有するロール状フィルムからフィルム4aを巻き出すフィルム供給工程301、フィルム4aの導電面に、酸処理、脱脂処理、水洗などが施される前処理工程302、導電面にめっき被膜を形成する電気めっき工程303、めっき液を除去したり、洗い流したり、防錆処理、更にこれを洗い流す処理、更に、乾燥などを行う後処理工程304、および、製造されためっき被膜付きフィルム4bをロール状フィルムに巻取る巻取工程305からなっている。フィルム4aの導電面が清浄な場合は、前処理工程302は省略される。製造されためっき被膜付きフィルム4bの後処理を要しない場合は、後処理工程304は省略される。

第1図において、フィルム巻き出し手段306から巻き出された導電 面を有するフィルム4aは、アキュムレータ307を通過する間に、更には、バランスロール部308を通過する間に、その搬送張力が調整される。その後、走行フィルム4aは、速度制御ロール部309を通過する間に、走行速度が実質的に一定に制御される。次いで、走行フィルム4aは、酸、脱脂処理部310、水洗部312を通過し、めっき液7が収容されているめっき浴6へ導入される。このめっき浴6の一部が拡大されて、第2図に示される。

15

20

25

第2図において、フィルム4aは、その導電面が陰極ロール1-1に電気的に接触した状態で走行した後、めっき浴6に導入される。めっき浴6において、フィルム4aは、液中ロール101-1を通過した後、めっき浴6から導出され、次の陰極ロール1-2に至る。

めっき浴 6 には、銅ボールが積層され充填されたケース102-1と102-2が収容されている。これらケース102-1、102-2は、陽極2を形成する。陰極ロール1-1、1-2は、陰極を形成する。これら両極間に、整流器(直流電源)3-1により給電される。めっき浴6において、各陽極2に対して、遮蔽板106-1、106-2が設けられている。この構成により、第2図において一点鎖線で囲まれて示される一つのめっきユニット6 a が形成される。

同様の次に続くめっきユニットが、陰極を形成する陰極ロール1-2、1-3、液中ロール101-2、陽極2を形成する銅ボールが積層され充填されたケース102-3と102-4、遮蔽板106-2、106-3、および、整流器(直流電源)3-2により形成されている。第1図に示される電気めっき装置において、このようなめっきユニット6aの多数個が、フィルム4aの搬送方向の上流側から下流側に向かい、連続して配列されている。フィルム4aは、各ユニット6aを順次通過し、その導電面に形成されるめっき被膜の厚みを増加させて行く。

各ユニット 6 a における電流条件は、フィルム 4 a に対して、0. 2 乃至 1 0 A / d m 2 の範囲の電流密度となるように、選択されるのが好ましい。この電流密度の定義は、後に説明される。各ユニット 6 a を順次通過し、最後のユニット 6 a から導出されたフィルム 4 a の導電面には、1 乃至 3 0 μ m の厚みのめっき被膜が形成される。

めっき浴6の底面には、空気導入口(エアー攪拌用ノズル)330-1、330-2、330-3、330-4が設けられている。これらの

20

空気導入口からは、フレッシュエアー331-1、331-2、331-3、331-4がめっき液7中に放出され、これにより、めっき浴6内のめっき液7が攪拌されるようにするのが好ましい。これにより、形成されるめっき被膜の均一性の向上が図られる。この場合、めっき被膜が形成される部位にフレッシュエアーが供給されることが、めっき被膜の均一性の向上に効果的である。これにより、形成されためっき被膜の極表面付近のめっき被膜を形成する金属のイオンの濃度が高められるからである。

図示されていないが、めっき浴 6 中のめっき液 7 は、めっき浴 6 から io 導出され、フィルターを通して汚れが取り除かれた後、再度、めっき浴 6 に導入されるようにして、常に循環していることが好ましい。

めっき被膜の形成が終わりめっき浴 6 から導出されためっき被膜付きフィルム 4 b は、フィルムの張力を検出するロール3 2 5 を通過する。その後、めっき被膜付きフィルム 4 b は、付着しているめっき液を除去するために水洗液 3 1 5 で処理する水洗工程 3 1 4、形成されためっき被膜を保護するために防錆処理液 3 1 7 で処理する防錆処理工程 3 1 6、過剰な防錆処理液を水洗液 3 1 9 で除去する水洗工程 3 1 8、水分を除去する乾燥炉をもつ乾燥工程 3 2 0 を順次通過する。

乾燥工程320から導出されためっき被膜付きフィルム4bは、速度調整部321、バランスロール部322を経て、その張力が調整される。 張力調整されためっき被膜付きフィルム4bは、アキュムレータ323 を通過し、フィルム巻取手段324によりロール状フィルムとして巻き取られる。

第3図に、本発明のめっき被膜付きフィルムの製造方法を実施しめっ き被膜付きフィルムを生産する工程において用いられる陰極ロールユニットの一例の拡大縦断面図が示される。この陰極ロールユニットは、陰

20

25

極ロール1、電解液収容皿10、および、電解液を調整する調整タンク 11、電解液を電解液収容皿10に供給する配管13、16からなる電 解液供給装置を含む。

第3図において、導電面5を有するフィルム4aは、導電面5が陰極ロール1側に位置した状態で、陰極ロール1に電気的に接触しながら、第3図において右方向に走行し、めっき浴6へと搬送される。陰極ロール1は、モータ(図示せず)に接続されており、第3図において右方向に回転する。

フィルム4aの導電面5と陰極ロール1の周面の一部との間には、液 10 膜8が介在している。記号dは、液膜8の厚みを示す。

陰極ロール1の下方には、電解液収容皿10が設けられている。電解液収容皿10には、濃度がコントロールされた電解液9が供給される。電解液9中に、陰極ロール1の一部が浸漬されている。陰極ロール1は、常に電解液9に浴されながら回転する。この回転に伴い、液膜8の形成部位に電解液9が供給される。これにより、フィルム4aの導電面5と陰極ロール1の表面との間に、液膜8が形成される。

電解液 9 は、濃度管理された電解液 1 2 が収容された調整タンク 1 1 から、配管 1 3、16 を通り、電解液収容皿 1 0 に供給される。配管 1 3、16 には、送液ポンプ 1 4、バルブ部(電磁バルブ) 1 5 が設けられている。電解液 1 2 の電解液収容皿 1 0 への供給量の制御は、バルブ 1 5 の作動、または、ポンプ 1 4 の動作により、厳密に行われる。電解 液収容皿 1 0 内の電解液 9 は、フィルム 4 a の走行方向の上流側に位置 するめっきユニット 6 a (第2図)からめっき液が持ち込まれるため、電解液 9 の濃度が変化する。この濃度変化を防止するため、排出口 1 7 より電解液が排出され、配管 1 6 から濃度調整された電解液 1 2 が供給される。

15

20

整流器 3 により、陰極ロール 1 から銅ボールが積層、充填されたケースからなる陽極 2 へ電流 I Aが供給される。この際の電流密度は、 0 . 2 乃至 1 0 A / d m²の範囲で選択されるのが好ましい。電流密度は、 第 2 図の一点鎖線で示した一つのユニット 6 a において、フィルム 4 a のめっき浴 6 中のめっき液 7 に浸されている部分の面積で、整流器 3 から投入される電流を除した値である。

第4図に、本発明のめっき被膜付きフィルムの製造方法を実施しめっき被膜付きフィルムを生産する工程において用いられる陰極ロールユニットの他の例の拡大縦断面図が示される。この陰極ロールユニットは、陰極ロール1、液体の受皿31、ドクターブレード21、弾性体22、液体供給部24、27、29を含む。

第4図の陰極ロールユニットにおける陰極ロール1の機能は、第3図の陰極ロールユニットにおける陰極ロール1の機能と同様である。しかし、両者の陰極ロール1は、それぞれの下方部分の装置構成において異なる。

第4図の陰極ロールユニットにおいて、陰極ロール1に対し、陰極ロール1に付着した付着物を取り除くドクターブレード21が設けられている。ドクターブレード21は、その先端部が陰極ロール1の表面に接触するようにして、支持体26により支持されている。ドクターブレード21に対し、液体25を供給する液体供給部24が設けられている。

更に、陰極ロール1に付着した付着物を取り除く弾性体22が設けられている。弾性体22は、その上面が陰極ロール1の表面に接触するようにして、支持体23により支持されている。弾性体22に対し、液体28を供給する液体供給部27が設けられている。

25 更に、また、陰極ロール1に、液体30を供給する液体供給部29が 設けられている。

15

図示はされていないが、液体25、28、30の供給は、個別に、ポンプ、バルブにより、厳密に制御されている。

液体25、28、30がめっき裕6に入らないように、受け皿31が 設けられ、受皿31には、受けた液体32を排出する排出口33が設け られている。

第3図において、陰極ロール1とフィルム4aの導電面5との間に形成される液膜8が存在する隙間の厚さをd、隙間に存在する液膜8を形成している液の導電率をσ、めっきのために陰極ロール1に流す電流値をI、陰極ロール1に液膜8を介して電気的に接触しているフィルム4aの導電面5の面積をCs、めっき被膜を形成する金属の還元電位をE。とするとき、

$$E_0 > [(I/Cs) \times d] / \sigma \qquad (i)$$

なる関係が満足されることが、陰極ロール1へのめっき被膜を形成する 金属の析出、付着を防止するのに必要である。

実際には、電流条件と金属の還元電位 E_0 により、電流値Iに対して、 (i)式を用いて、隙間の厚さ dを横軸にとり、導電率 σ を縦軸にとり、 両者の関係をグラフ化し、このグラフにおいて描かれる線の上側の範囲 の 算電率 σ を用いることにすると良い。

本発明者等は、フィルム4aの導電面5が、液膜8を介して、陰極ロール1に電気的に接触して搬送されていても、導電面5と陰極ロール1との間の電位差がめっき被膜を形成する金属の還元電位E。の値を越えると、めっき被膜を形成する金属が陰極ロール1に析出する現象が現れることを見出した。本発明者等は、如何にしたらこの析出現象を防止することが出来るかを種々検討した。その結果、上記式(i)に示される 関係を見出した。

本発明のめっき被膜付きフィルムの製造方法は、陰極ロール1とフィ

15

20

25

ルム 4a の 導電面 5 との間の隙間の厚さ d、この隙間に存在する液膜 8 を形成している液の 導電率 σ 、めっきのために陰極ロール 1 に流す電流値 I、および、陰極ロール 1 に液膜 8 を介して電気的に接触しているフィルム 4a の 導電面 5 の面積 C s の少なくとも一つを制御することにより、 $[(I/Cs) \times d]/\sigma$ の値を、めっき被膜を形成する金属の還元電位 E_0 の 値未満に維持することを特徴とする。

これにより、めっき被膜を形成する金属の陰極ロール1への析出現象は、防止される。しかも、導電面5と陰極ロール1との間には、液膜8が介在しているので、フィルム4aの搬送状態も良好に維持される。

液膜8を形成する液として、めっき液7に含まれる電解液が用いられる。液膜8を形成する液として用いられる電解液9は、金属塩を発生しにくい点で、硫酸を主体とする電解液が好ましい。めっき被膜を形成する金属が銅である場合は、電解液は、硫酸を主体とする電解液であることが特に好ましい。

液膜8を形成する電解液9の導電率の調整は、調整タンク11において、供給する電解液の導電率を監視し、イオン交換水などで高濃度の硫酸を薄めた液により調整すると良い。導電率が調整された電解液は、高精度な導電率計でその導電率が監視される。導電率が所望の値より低い場合は、高濃度の硫酸が、導電率が所望の値より高い場合は、イオン交換水が、調整タンク11に供給される。この導電率の調整は、フィードバック制御されるのが好ましい。

第3図に示すように、陰極ロール1の下方に位置する電解液収容皿1 0に、調整タンク11から供給される導電率が調整された電解液9が溜められる。陰極ロール1の一部が、電解液収容皿10に溜められている電解液9に接する、または、浸漬するように、陰極ロール1が電解液収容皿10に対し配置される。陰極ロール1の回転により、陰極ロール1

20

の表面に付着した電解液 9 が、液膜 8 の形成部位へと運ばれ、その部位 において、走行しているフィルム 4 a と陰極ロール 1 の導電面 5 との間 に、液膜 8 が形成される。

第4図に示す陰極ロール1においては、液体供給部24から液体25 がドクターブレード21に供給される。ドクターブレード21に供給さ れた液体25は、陰極ロール1の表面に付着し、陰極ロール1の回転に より、液膜8の形成部位へと運ばれ、そこにおいて、走行しているフィ ルム4aの導電面5と陰極ロール1との間に、液膜8を形成する。

また、第4図に示す陰極ロール1においては、液体供給部27から液 10 体28が弾性体22に供給される。弾性体22に供給された液体28は、 陰極ロール1の表面に付着し、陰極ロール1の回転により、液膜8の形成部位へと運ばれ、そこにおいて、走行しているフィルム4aの導電面 5と陰極ロール1との間に、液膜8を形成する。

また、更に、第4図に示す陰極ロール1においては、液体供給部29から液体30が陰極ロール1に直接供給される。陰極ロール1に供給された液体は、陰極ロール1の表面に付着し、陰極ロール1の回転により、液膜8の形成部位へと運ばれ、そこにおいて、走行しているフィルム4aの導電面5と陰極ロール1との間に、液膜8を形成する。

第4図に示す陰極ロール1においては、液膜8の形成手法として、上の3つの手法の少なくとも一つが用いられる。それぞれの手法において隙間 d に存在する液膜8を形成している液の導電率は、基本的には、上記(i)式を満足していれば良い。

実際の生産管理においては、導電率が、1mS/cm以上100mS/cm以下の範囲において管理されるのが好ましい。

25 導電率が1mS/cm未満の場合、めっき被膜を形成する金属の陰極 ロール1への析出を回避しようとすると、投入電流の電流値を低く選定

15

20

25

せざるを得なくなる。この低い電流値を用いた生産工程は、めっき被膜付きフィルム4bの生産性の低下をもたらす。よって、導電率が1mS/cm未満であることは、生産性を高めるためには、好ましくない。

10 導電率が100mS/cmを超える場合、形成されためっき被膜からの金属の溶出が発生し易くなる。よって、導電率が100mS/cmを超えることは、この金属の溶出現象が発生し易い点から好ましくない。

隙間 d の大きさは、フィルム 4 a の搬送張力により制御することが出来る。理論的には、一般に知られている次に示すホイルの式(ii)がある。

$$d = \alpha \times r \times (\beta \mu v / T)^{2/3} \qquad (ii)$$

ここで、 α 、 β は定数、rは陰極ロール1の径、 μ は液膜8の液体の粘度、vはフィルム4 aの搬送速度、Tはフィルム4 aの搬送張力を示す。

この理論式に基づき隙間 d とフイルム 4 a の搬送張力Tとの関係を見出しても良いが、隙間 d は、搬送張力Tの 2 / 3 乗におおよそ逆比例する関係があるので、この関係を用いて、隙間 d と搬送張力Tとを制御することが可能である。

この後者の手法に基づけば、例えば、ある隙間 d をその 1/2 の隙間に調整したい場合、搬送張力を $2^{(3/2)}$ $\stackrel{1}{\sim}$ 2 . 8 3 倍にすれば良いことが分かる。このように隙間 d を制御することで(i)式を満足する生産条件の設定が可能となる。

15

20

生産工程において、フィルム4aの搬送張力Tは、10N/m以上320N/m以下の範囲にあることが好ましい。搬送張力Tが10N/m未満の場合、フィルム4aの走行経路において、フィルム4aの走行状態が蛇行する場合がある。この現象の存在は、生産工程におけるフィルム4aの搬送状態の制御がうまく行かないことを意味する。搬送張力Tが320N/mを超える場合、フィルム4aの導電面5に形成されるめっき被膜の金属が内部歪みを有している場合、形成されるめっき被膜付きフィルム4bにカールが発生する現象が現れる。この現象の存在は、品質の良いめっき被膜付きフィルム4aの生産が出来ないことを意味する。

隙間 d の大きさは、2 μ m以上5 0 0 μ m以下であることが好ましい。隙間 d の大きさが 2 μ m未満の場合、陰極ロール 1 の表面の表面粗さの関係もあって、フィルム 4 a の導電面 5 と陰極ロール 1 とが直接接触する機会が増える。この直接接触の頻度が増大すると、良好な品質のめっき被膜付きフィルム 4 b が得られない。隙間 d の大きさが 5 0 0 μ mを超える場合、フィルム 4 a の走行経路において、フィルム 4 a の走行状態が蛇行する場合がある。この現象の存在は、生産工程におけるフィルム 4 a の搬送状態の制御がうまく行かないことを意味する。

搬送張力 T は、張力検出ロール 3 2 5 (第 1 図)により検出される。 この検出される搬送張力 T の値に関する信号をもって、検出される搬送 張力 T の値が実質的に一定になるように、速度調整部 3 2 1 のフィルム 搬送速度が制御され、その結果、搬送張力 T の値が実質的に一定になる ように制御される。この制御は、フィードバック制御とするのが良い。

第1図におけるフィルム4aの搬送速度の制御は、陰極ロール1が駆 動ロールになっており、速度制御部309において基本速度が設定され されることにより行われる。この制御方式において、陰極ロール1-1、

15

20

陰極ロール1-2との間におけるフィルム4aに作用するドロー比設定が可能となっている。また、この制御方式において、各陰極ロール1間のドロー比設定が徐々に高くなるようになし、速度調整部321部でフィルム4bの最終的な搬送速度が制御される。この制御方式の採用により、めっき浴6の上方に位置する陰極ロール1におけるフィルム4aの最大搬送張力Tmaxは、張力検出ロール325部において生じる。従って、フィルム4aの搬送張力Tは、最大搬送張力Tmaxの値に基づき制御することが可能となり、かつ、そのようにすることが好ましい。

隙間 d の大きさは、搬送張力Tが小さい程、大きくなる。最も搬送張力Tが低い一番初めの陰極ロール1-1上で隙間 d の測定を行い、この値が目標値に入るように搬送張力Tを上下させる制御を行っても良い。

陰極ロール1上に、めっき被膜を形成する金属が時には析出する場合がある。この場合の対策として、陰極ロール1に対して、この析出した金属を掻き取るブレード21を設けておくと良い。ブレード21の刃先は、陰極ロール1の表面に対して垂直な方向ではなく、陰極ロール1の回転方向に傾斜していることが好ましい。こうすることによって、めっき被膜を形成する金属が万が一陰極ロール1上に析出したとしても、析出した金属は、ブレード21によって掻き取られ、除去される。

ブレード21は、支持体26によって支持されている。支持体26は、 陰極ロール1の回転方向と直角の方向(陰極ロール1の幅方向)におけるブレード21の刃先の押しつけ力を調整出来る機能を有する。これにより、ブレード21の刃先の陰極ロール1の表面に対する押しつけ力が 陰極ロール1の幅方向に亘り均一になるように調整される。

ブレード21は、陰極ロール1に接触するものであるため、その材質 25 は、金属反応が生じ難いものであり、または、接触部における電解液の 存在に起因する電池現象(酸化還元現象)が発現し難いいものであるこ

15

20

とが好ましい。この観点から、ブレード21は、樹脂製あるいはセラミックス製であることが好ましい。プラスチック樹脂製ブレードとしては、例えば、イーエル・ジャパン (株) 製のプラスチックドクターブレード" E500"、エコ・ブレード(株)製のUHMWポリエチレン系プレード、(株)東京製作所製のふっ素樹脂系のTSドクターブレードがある。セ

(株) 東京製作所製のふっ素樹脂系のISドクタープレードがある。セラミックス製プレードとしては、例えば、(株) 東京製作所製のSICニューセラミックスプレードがある。

陰極ロール1に析出した金属をふき取るための弾性体22が、陰極ロール1の表面に摺接して設けられていても良い。弾性体22は、支持体23によって支持されている。支持体23は、陰極ロール1の回転方向と直角の方向(陰極ロール1の幅方向)における弾性体22の押しつけ力を調整出来る機能を有する。これにより、弾性体22の陰極ロール1の表面に対する押しつけ力が陰極ロール1の幅方向に亘り均一になるように調整される。

弾性体22は、スポンジ、不織布、発泡フォームなどで形成される。 その材料は、ポリウレタン、PVA(ポリビニルアルコール)、PVC(ポリ塩化ビニル)、ポリエチレン、ブチル系、ネオプレン系のゴム系素材であることが好ましい。この中でも、PVA(ポリビニルアルコール)やPVC(ポリ塩化ビニル)は、硫酸を主体とする電解液やめっき液に対して耐性があるので特に好ましい。

ブレード21と弾性体22とを併用することで、陰極ロール1に析出 した金属をより効率良く取り除くことが出来る。例えば、ブレード21 の陰極ロール1への当たりが悪い箇所ですり抜けた析出した金属が弾性 体22によりふき取られる。

25 金属が析出した陰極ロール1、プレード21、弾性体22に対し、連 続的または間欠的に、液体が供給されるようにすると良い。この液体に

15

20

25

より、析出した金属は洗い流される。これにより、析出した金属の除去がより効率良くなされる。一方、この液体は、式(i)における液膜8を形成している液の導電率σを一定に保つための手法として用いられる。

液体は、第4図に示されるように、液体供給部24、液体供給部27、 あるいは、液体供給部29から供給される。すなわち、ブレード21に 対し、液体供給部24から液体25が、弾性体22に対し、液体供給部 27から液体28が、あるいは、陰極ロール1に対し、液体供給部29 から液体30が供給される。

めっき被膜付きフィルムを製造するのに用いられるベースフィルムとしては、ポリイミド樹脂、あるいは、ポリエステル樹脂から形成されているフィルムが好ましく用いられる。電子回路材料などで使用される銅被膜付きフィルムを形成する場合には、汎用的なポリエステル樹脂フィルムがベースフィルムとして好ましく用いられる。回路ICなどの実装でのハンダ耐熱性が要求される場合は、ポリイミド樹脂フィルムがベースフィルムとして好ましく用いられる。

ベースフィルムの材質の具体例は、次の通り。ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンー 2,6ーナフタレート、ポリエチレンー α,βービス(2ークロルフェノキシエタンー 4,4'ージカルボキシレート)などのポリエステル、ポリエーテルエーテルケトン、芳香族ポリアミド、ポリアリレート、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリパラジン酸、ポリオキサジアゾールおよびこれらのハロゲン基あるいはメチル基置換体、更に、これらの共重合体、これらの更に他の有機重合体を含有したもの。ベースフィルムは、添加剤、例えば、滑剤、可塑剤などを含んでいても良い。

ベースフィルムとしては、次式に示される繰り返し単位を85モル% 以上含むポリマーを溶融押出して得られる未延伸フィルムを、二軸方向 に延伸配向して機械特性を向上せしめたフィルムが特に好ましく用いられる。

10

15

20

27

(但し、XはH、CH₃、F、C1基を示す)

ベースフィルムとしては、次式に示される繰り返し単位を50モル% 以上含むポリマーからなり、湿式あるいは乾式製膜したフィルム、ある いは、このフィルムを二軸延伸および/または熱処理せしめたフィルム も好ましく用いられる。

(但し、XはH、CH3、F、C1基、m、nは0~3の整数を示す)

10

15

20

25

フレキシブル回路用の場合、ベースフィルムの厚さは、 $6\sim1~2~5~\mu$ mのものが多用され、特に、 $1~2\sim5~0~\mu$ mの厚さのものが好適に用いられる。

このような厚さが薄く、かつ、幅の広いフィルムを、第1図に示されるめっき被膜付きフィルムの製造装置の中を円滑に走行させることは、かなり難しい。フィルム4aの導電面5と陰極ロール1との間に液膜8が存在していても、フィルム4aが円滑に走行しない場合がある。

陰極ロール1の表面粗さRmaxが1µmを超えると、搬送張力Tを上げたときに、介在している液膜8の厚さdよりも、陰極ロール1の表面に存在している表面突起の高さが大きくなり、表面突起がフィルム4aに食い込む現象が生じる場合がある。この現象が生じると、フィルム4aが陰極ロール1の表面にグリップされる。その結果、フィルム4aに局所的な張りが発生し、また、これに応じて局所的な弛みも発生する。

この状態が発生すると、フィルム4aの導電面5、あるいは、形成が終わったばかりのめっき被膜面にキズが生じる。また、陰極ロール1の表面粗さがフィルム4aの導電面5に転写される問題も発生する。

本発明のめっき用陰極ロールは、その表面粗さRmaxを1µm以下とすることにより、この問題を解決している。この陰極ロールを用いることにより、厚さが薄いフィルムであっても、陰極ロール上での液膜潤滑が円滑となり、製造装置中のフィルムの搬送を安定させることに成功した。

しかしながら、陰極ロールが通常のSUS316からなる場合、使用時間が経過するに従い、粒界腐蝕が少しずつ進行する。また、表面硬度がビッカース硬度Hvで70位であるため、フィルムとの摩擦により、表面が徐々に摩耗し、傷が形成される。その結果、表面粗さRmaxが1μm以下の条件が維持出来なり、製品の表面品位が悪化する。

15

20

この問題の解決のため、種々の手法が検討された。その結果、めっき 被膜を形成している金属よりも硬度が高い材料で、陰極ロールの表面を 形成することが見出された。で、この摩耗による表面粗さRmaxの上 昇を抑制することが可能となる。なお、めっき被膜を形成する銅のビッ カース硬度は、約170である。

本発明者等により、高いビッカース硬度を有する陰極ロールの検討、特に、表面処理の検討が種々なされた。その結果、タングステンを主体とする表面処理が非常に良いことが見出された。更に、タングステンを50%以上含有し、その他、クロム、ニッケル、炭素から選ばれる元素を少なくとも1種類以上を含むものがより好ましいことが判明した。また、更に、タングステンを60~80重量%、クロムを15~25重量%、ニッケルを1~10重量%、炭素を1~10重量%含有する表面処理がより好ましいことが判明した。こうした材料は、硫酸を主体とした塩酸などが添加されためっき液に対しても耐性があり、非常に好ましい。

表面処理方法としては、真空蒸着法やスパッタ法を含むPVD法、CVD法、溶射法、イオン注入法、めっき法などが挙げられる。これらの中でも、溶射法による表面処理が簡便かつ非常に硬い膜が簡単に製造出来るので好ましい。また、溶射法は、処理の厚膜化が容易であるため、表面処理後、ダイヤモンド砥材により表面粗さを容易に調整出来るので好ましい。

溶射法としては、ガス式溶射、電気式溶射が挙げられる。フレーム溶射法としては、粉末式、溶線式、溶棒式のフレーム溶射法、爆発溶射法、アーク溶射法、プラズマ溶射法が挙げられる。緻密な膜でかつタングステンカーバイド系の膜を形成出来る爆発溶射法が非常に好ましい。

25 めっき液の浸食が母材まで到達しないように、表面処理の膜厚としては、30μm以上が好ましく、更に、耐久性の面から、表面処理は、1

0 0 μ m以上の膜厚で施すことがより好ましい。更に、めっき液が溶射膜内部に浸食しないように、溶射膜の気孔率は2%以下であることが好ましい。

このようなめっき用陰極ロールを用いることにより、フィルム表面に おける傷の発生が防止される。また、フィルムに作用する陰極ロールに よる不自然なグリップカの発生が防止され、フィルムの搬送の安定化が 図られる。これらの結果、フィルムへの良好なめっき被膜の形成が可能 となる。

このような陰極ロールは、陰極ロールへ複数本のフィルム通しを可能とする。このような陰極ロールを用いると、陰極ロール対し複数列のフィルムを同時に走行させても、複数列のフィルムによるランダムな張力の駆け引きが起こらず、それぞれのフィルムについて良好な搬送が維持される。多数の陰極ロールと液中ロールからなるフィルムの走行方向の転換が多い(ターン数の多い)長尺の走行経路を有する工程において、本発明の陰極ロールの効果が非常に良く発揮される。これにより、省スペースで大量のめっき被膜つきフィルムの生産が可能となり、従来生産効率が悪いとされていためっき被膜付きフィルムの生産効率の飛躍的向上がもたらされる。

実施例

10

15

25

20 以下に本発明の実施例が示される。本発明は、これらに限定されるものではない。実施例中の各特性値は、次の方法に従って測定された。

(1) プラスチックフィルムの表面張力

JIS K6766-1977 (ポリエチレンおよびポリプロピレン の濡れ試験方法) に準じて行った。標準液として、表面張力56 d y n e / c m以下は、ホルムアミド/エチレングリコールモノエチルエーテル混合溶液を用い、表面張力57~73 d y n e / c m の範囲は、水(7

2.8 d y n e / c m) / エチレングリコール (47.7 d y n e / c m) の混合液を用い、表面張力を測定した。

(2)接触角

協和界面科学 (株) 製FACE接触角計を用い、液滴法によって測定 した。

(3)スパッタ膜の膜厚

触針式表面粗さ計を用いて、測定した。試料は、スパッタ膜形成前に 溶剤で除去可能なインクを一部分に塗布しておいた後、スパッタ膜を形成し、次いで、成膜後にインク塗布部分を除去して測定した。

10 (4) めっき膜の膜厚

めっき被膜の一部分をエッチング液により除去し、キーエンス (株) 製のレーザ顕微鏡を用いて、その段差を測定して求めた。

(5) 導電率

(株) コス製の導電率メーターCEH-12を用いて測定した。測定方式は、交流2電極方式で、測定範囲は0~199mS/cmセンサーである。

(6)液膜隙間

20

25

第6図に示す装置を使用して、液膜隙間の大きさを測定した。第6図に示す測定装置においては、液膜厚さ測定用架台41に取り付けられたスライドガイド42に沿って、ケーブル43付きの変位計44が移動され、検出信号をアンプユニット45で増幅、出力させた。測定センサ(変位計44)として、キーエンス(株)製のレーザ変位計を用い、液膜の厚さを同定した。センサヘッドには、"LK-010"超小型・高精度CCDレーザ変位センサ、アンプユニット45には、"LK-3100"を用いた。センサスペックは、分解能0.1 μ m、スポット径20 μ m、基準距離10 μ mとした。

15

25

(7)搬送張力

陰極ロールの両側にロードセルの方式のセンサーを取付け測定した。センサーは、ミネベア(株)製の"C2G1-25K"型を用いた。測定範囲は、0~250Nの測定が可能な範囲とした。ロール重さとフィルム搬送の抱き角に基づき得られた張力値を校正したものを張力値とした。

また、製品の生産中の搬送張力は、簡便な方法として、第8図に示す 測定装置で測定した。フィルム4aを陰極ロール61a、搬送ロール6 2、陰極ロール61b上にかけ渡して搬送した。スライドガイド64に 取り付けられたスライドユニット65上にプッシュプルゲージ63を配 置し、フィルム押しつけロール68をフィルム4aに押しつけ、15m m押し込んだところでスライドがストップするようにストッパー66を 配置した。フィルム4aのパス途中にロール68を15mm押しつけた 状態にして、この時の搬送フィルム4aから受ける力をプッシュプルゲージ63で測定した。プッシュプルゲージ63として、アイコーエンジニアリング(株)製の"MODEL-9550"を用いた。

(8) 表面粗さ

触針式三次元表面粗さ計を用いて測定した。

実施例1

20 この実施例は、銅付きフィルムをフレキシブル回路基板に応用したものである。

(1) 導電面付きフィルムの製作

減圧装置の中で、ロール状に巻き取ったフィルムを巻き出しながら、 処理し、その後フィルムを巻き取りロール状にする装置で、プラズマ処理、ニッケルークロム層成膜、銅層成膜を行った。

厚さ25μm、幅520mm、長さ12, 500mのポリイミドフィ

15

25

ルム"カプトン"1 (米国デュポン社の登録商標)のロール状体を用意した。

上記フィルムの片面に、2m/分の速度でアルゴンガスのグロー放電プラズマ処理を実施した。処理は高電圧を印加した棒状の電極に対して2cmの距離でフィルムを搬送し、かつ接地電極となっている電極対をもつ内部電極方式のプラズマ装置を使用した。アルゴンガス圧力は2.5Pa、1次出力電圧2kV、高周波電源周波数110kHzの条件でフィルムを2m/分で処理し、グロー放電プラズマ層を形成した。処理されたフィルムの表面張力は、70dyne/cm以上で、接触角は43度であった。

次いで、アルゴンガス圧 2.6×10⁻² Paにて、クロム 20重量%、 ニッケル 80重量%をターゲットとして用い、30nmのニッケルクロ ム層をDCマグネトロンスパッタ法を適用して形成した。その後、純度 99.99重量%の銅をターゲットとして用い、100nmの銅層をD Cマグネトロンスパッタ法を適用して形成した。

上記フィルムから、スパッタ膜形成のための条件出しやリード部分を 除いて、12,000mのスパッタ膜付きフィルムを製造した。

(2) めっき被膜の形成

得られたロール状のスパッタ膜付きフィルム12,000mを、3,000mのロール状体に4分割して、520mm×3,000mのロール状体の導電膜付きフィルムを4本準備し、そのうち1本を次に示すめっき装置に通してめっき被膜を形成した。

めっき装置として、第1図および第3図に示す装置を用いて、陽極2に銅を用い、第2図における一点鎖線内のユニット6aを16ユニットとしためっき回路およびめっき装置を構成した。8μmの厚さの銅のめっき被膜を有するフィルム4bを製造した。

陰極ロール1は、直径210mm、長さ800mm、肉厚10mmの SUS316の円管から形成された。陰極ロール1-1から液中ロール 101-1を介して陰極ロール1-2まで、フィルム4aをパスさせた ときのフィルムパス長は4mとした。パス長は、陰極ロール1の頂点か ら次の陰極ロールの頂点までのフィルム4aの長さを云う。従って、め っき部の全パス長は、64mである。

フィルムの前処理条件、めっき条件、防錆処理条件は、表1に示す。 銅めっきの電流密度は、陰極ロール1と液中ロール101のパスの繰り 返し数が進むにつれて、徐々に電流密度が上昇するように設定した。第 1から第16ユニットの整流器3毎の電流設定条件は、表2に示す通り である。

10

15

20

25

表2の電流条件と銅の還元電位 0.337 Vにより、各電流値に対して、(i)式を用いて液膜隙間 d と導電率 σ の関係をグラフ化したものが第5 図に示される。第5 図のグラフにおける各電流値を示す線の上側になるように導電率を制御すればよいことになる。銅の還元電位は、C u イオンの活量、あるいは、濃度により変化するが、銅の標準単位電極電位である C u 2 + / C u の値は、0.337 Vであり、銅イオンの濃度から、この値より小さい値になるので、これを還元電位とした。また、フィルム 4 a の導電面 5 と陰極ロール1の接触面積は、抱き角を120度としたので、520 mm幅×約220 mmで計算した。

液膜隙間 d は、第6図に示すように、レーザ変位計 4 4 で隙間 d の大きさを測定し、隙間 d が 3 0 0 μ m以下になるようにフィルム搬送張力 T の設定をした。フィルム張力設定は、第1図に示す S 字ラップの速度制御部 3 0 9 によって適度に張力をカットし、その後、順次ロールの回転速度にドローをかける方式で張力を設定した。陰極ロール(張力検出ロール部) 3 2 5 でロードセルによって自動で圧力検出を行い、張力が

15

20

25

160N/mになるように、速度調整部321の駆動モータの速度でフィードバック制御した。最も張力が低い陰極ロール1-1部の液膜隙間 d を第6図の検出装置で測定したところ、125μmであった。

搬送速度は1m/分とし、次いで陰極ロール1-1~1-17の各陰極ロールのモータ駆動設定において段階的にドロー比率設定を行い、順次速度を上げ、張力を徐々に上げる方式とした。

各ユニット6 a 毎に導電率を変化させるように制御しても良よいが、装置が高価になるために、すべてのユニット6 a に対して、銅析出限界とならないように、液膜の導電率を、10mS/cmになるように調整した。第3図における調整タンク11の硫酸濃度を調整して、100m1/分となるようにポンプ14の設定を行い、受け皿10中の液濃度をコントロールした。

その結果、陰極ロール1表面には銅の析出がなく、搬送状態も非常に 安定していて、良好な巻姿のロール状フィルム4bを得た。

その後、めっき銅表面を観察したところ、めっき表面の異常な突起や 凹みが少なく、表面品位の優れた銅めっき被膜付きフィルムが製造出来 たことが確認された。異常な突起や凹みの個数は、表3に示す。

(3) 回路パターンの形成

感光性液体レジストをコーティングし、 60μ mピッチ、すなわち、 銅導体線幅 30μ m、導体線間 30μ mの回路パターン1,024本の マスクを使い紫外線露光と現像を行い、塩化第二鉄エッチング液で回路 パターンを形成した。その回路パターン50枚を150倍の実態顕微鏡 で観察し、欠け(10μ m以上の欠けは不合格で、それが1,024本 中に1本以上あればその回路パターンを不合格とする)、および、断線に よるパターンの良否を判定した結果を表4に示す。これにより収率100%の回路パターンが得られた。

表 1

工程	条件	
1. 脱脂	エースイクリーン A110	30 g/l
	温度	50 ℃
	時間	2 分
2. 酸活性	硫酸	10 ml/l
,,,,,,,	温度	30 ℃
	時間	0.5 分
3. 陰極処理	硫酸銅	30 g/l
	硫酸	150 g/l
	光沢剤(荏原ユージライト)	3 ml/l
	温度	25 ℃
	時間	2 分
	電流密度	0.5 A/dm ²
4. 銅めっき	硫酸銅	200 g/l
	硫酸	50 g/l
	金属銅	50 g/l
	光沢剤(荏原ユージライト)	2 ml/l
	塩素	60 mg/l
	温度	30 ℃
	時間 (厚さ:10 µ)	20 分
	電流密度	$0.5 \rightarrow 3 \text{ A/dm}^2$

表 2

整流器 No.	設定電流値	整流器 No.	設定電流値
3-1	10 A	3-10	175 A
3-2	16 A	3-11	185 A
3-3	25 A	3-12	198 A
3-4	32 A	3-13	208 A
3-5	45 A	3-14	215 A
3-6	68 A	3-15	218 A
3-7	95 A	3-16	220 A
3-8	135 A	合計	2,000 A
3-9	155 A		

表 3 520mm x 100mm 内の突起の個数

突起、窪みの最大径	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2
$3 \sim 10 \mu \text{ m}$	2	5	> 100	
$11 \sim 50 \mu m$	3	4	56	
51 ~ 100 μ m	0	0	32	
101 μ m 以上	0	0	8	

5 表 4

10

15

20

	実施例1	実施例 2	比較例1	比較例2
良品数	50	50	3	-
枚/50 枚	100 %	100 %	6 %	

実施例2

この実施例は、銅付きフィルムをフレキシブル回路基板に応用したも のである。

(1) 導電面付きフィルムの製作

実施例1と全く同様の導電面付きフィルムを作成した。

(2) めっき被膜の形成

得られたロール状のスパッタ膜付きフィルム12,000mを、3,000mのロール状体に4分割して、520mm×3,000mのロール状体の導電膜付きフィルムを4本準備し、そのうち1本を次に示すめっき装置に通してめっき被膜を形成した。

めっき装置として、第1図および第4図に示す装置を用いて、陽極2に銅を用い、第2図における一点鎖線内のユニット6 a を16ユニットとしためっき回路およびめっき装置を構成した。8μmの厚さの銅のめっき被膜を有するフィルム4bを製造した。

陰極ロール1は、直径210mm、長さ800mm、肉厚10mmの

SUS316の円管から形成された。陰極ロール1-1から液中ロール101-1を介して陰極ロール1-2まで、フィルム4aをパスさせたときのフィルムパス長は4mとした。パス長は、陰極ロール1の頂点から次の陰極ロールの頂点までのフィルム4aの長さを云う。従って、めっき部の全パス長は、64mである。

フィルムの前処理条件、めっき条件、防錆処理条件は、表1に示す。 銅めっきの電流密度は、陰極ロール1と液中ロール101のパスの繰り 返し数が進むにつれて、徐々に電流密度が上昇するように設定した。第 1から第16ユニットの整流器3毎の電流設定条件は、表2に示す通り である。

10

15

表2の電流条件と銅の還元電位 0.337 Vにより、各電流値に対して、(i)式を用いて液膜隙間 d と導電率 σ の関係をグラフ化したものが第 5 図に示される。第 5 図のグラフにおける各電流値を示す線の上側になるように導電率を制御すればよいことになる。銅の還元電位は、C u イオンの活量、あるいは、濃度により変化するが、銅の標準単位電極電位である C u 2 + / C u の値は、0.337 Vであり、銅イオンの濃度から、この値より小さい値になるので、これを還元電位とした。また、フィルム 4 a の導電面 5 と陰極ロール 1 の接触面積は、抱き角を 1 2 0 度としたので、5 2 0 mm幅×約 2 2 0 mmで計算した。

20 液膜隙間 d は、第6図に示すように、レーザ変位計 4 4 で隙間 d の大きさを測定し、隙間 d が 3 0 0 μ m以下になるようにフィルム搬送張力 T の設定をした。フィルム張力設定は、第1図に示すS字ラップの速度制御部 3 0 9 によって適度に張力をカットし、その後、順次ロールの回転速度にドローをかける方式で張力を設定した。陰極ロール(張力検出ロール部) 3 2 5 でロードセルによって自動で圧力検出を行い、張力が160N/mになるように、速度調整部 3 2 1 の駆動モータの速度でフ

15

20

イードバック制御した。最も張力が低い陰極ロール1-1部の液膜隙間 d を第6図の検出装置で測定したところ、80μmであった。

搬送速度は1m/分とし、次いで陰極ロール1-1~1-17までの 各陰極ロールのモータ駆動設定において段階的にドロー比率設定を行い、 順次速度を上げ、張力を徐々に上げる方式とした。

各ユニット6a毎に導電率を変化させるように制御しても良よいが、装置が高価になるために、すべてのユニット6aに対して、銅析出限界とならないように、液膜の導電率を、2mS/cmになるように調整した。すなわち、第4図におけるドクターブレード21を洗い流す液体25として硫酸を用い、その導電率を2mS/cmとし、3分毎に2秒間のシャワー供給で、2分毎に200m1の液体25を供給した。また、弾性体22に供給する液体27として硫酸を用い、その導電率を2mS/cmとし、3分毎に2秒間のシャワー供給で、2分毎に200m1の液体27を供給した。ドクターブレード21への硫酸シャワー供給の1分後に液体27を供給するシーケンスとした。また、陰極ロール1に供給する液体30として硫酸を用い、その導電率を2mS/cmとし、3分毎に2秒間のシャワー供給で、2分毎に200m1の液体30を供給した。弾性体22への硫酸シャワー供給の1分後に液体30を供給した。弾性体22への硫酸シャワー供給の1分後に液体30を供給するシーケンスとした。これらにより、液膜8を形成する液濃度をコントロールした。

液膜隙間 d と導電率 σ の関係から、(i)式を満たさなくなった部分が生じ、陰極ロール1からのフィルム 4 a の離れ際に、陰極ロール1上に銅が析出するのが観察された。しかし、析出した銅は、ブレード 2 1、および、弾性体 2 2 により除去され、その部分が次にフィルム 4 a に向かい合うときには、清浄な状態にあることが確認された。

陰極ロール1の表面に銅の析出が一時的にあったとしても、その除去

が直ちになされるので、フィルム4aを損傷することもなく、フィルム4aの搬送状態も安定に維持される。銅めっき被膜付きフィルム4bの 良好な巻姿のロール状フィルムが製造された。

プレード21は、イーエルジャパン(株)製のプラスチックプレード E500を使用した。弾性体22のスポンジは、PVAのスポンジを使用して、押し圧力が50N/mになるように、陰極ロール1に均一に押しつけた。

その後、めっき銅表面を観察したところ、めっき表面の異常な突起や 凹みが少なく、表面品位の優れた銅めっき被膜付きフィルムが製造出来 たことが確認された。異常な突起や凹みの個数は、表 3 に示す。

(3) 回路パターンの形成

感光性液体レジストをコーティングし、 60μ mピッチ、すなわち、 銅導体線幅 30μ m、導体線間 30μ mの回路パターン1,024本の マスクを使い紫外線露光と現像を行い、塩化第二鉄エッチング液で回路 パターンを形成した。その回路パターン50枚を150倍の実態顕微鏡 で観察し、欠け(10μ m以上の欠けは不合格で、それが1,024本 中に1本以上あればその回路パターンを不合格とする)、および、断線に よるパターンの良否を判定した結果を表4に示す。これにより収率100%の回路パターンが得られた。

20 比較例1

10

15

この比較例は、銅付きフィルムをフレキシブル回路基板に応用したものである。

(1) 導電面付きフィルムの製作

実施例1と全く同様の導電面付きフィルムを作成した。

25 (2) めっき被膜の形成

得られたロール状のスパッタ膜付きフィルム12,000mを、3,

000mのロール状体に4分割して、520mm×3,000mのロール状体の導電膜付きフィルムを4本準備し、そのうち1本を次に示すめっき装置に通してめっき被膜を形成した。

めっき装置として、第1図および第3図に示す装置を用いて、陽極2に銅を用い、第2図における一点鎖線内のユニット6aを16ユニットとしためっき回路およびめっき装置を構成した。8μmの厚さの銅めっき被膜を有するフィルム4bを製造した。

陰極ロール1は、直径210mm、長さ800mm、肉厚10mmの SUS316の円管から形成された。陰極ロール1-1から液中ロール 101-1を介して陰極ロール1-2まで、フィルム4aをパスさせた ときのフィルムパス長は4mとした。パス長は、陰極ロール1の頂点か ら次の陰極ロールの頂点までのフィルム4aの長さを云う。従って、め っき部の全パス長は、64mである。

10

15

フィルムの前処理条件、めっき条件、防錆処理条件は、表1に示す。 銅めっきの電流密度は、陰極ロール1と液中ロール101のパスの繰り 返し数が進むにつれて、徐々に電流密度が上昇するように設定した。第 1から第16ユニットの整流器3毎の電流設定条件は、表2に示す通り である。

液膜隙間 d は、第6図に示すように、レーザ変位計 4 4 で隙間 d の大きさを測定し、隙間 d が 3 0 0 μ m以下になるようにフィルム搬送張力 T の設定をした。フィルム張力設定は、第1図に示す S 字ラップの速度制御部 3 0 9 によって適度に張力をカットし、その後、順次ロールの回転速度にドローをかける方式で張力を設定した。陰極ロール 3 2 5 (張力検出ロール部)でロードセルによって自動で圧力検出を行い、張力が160N/mになるように、速度調整部 3 2 1 の駆動モータの速度でフィードバック制御した。最も張力が低い陰極ロール 1 一1 部の液膜隙間

15

20

25

dを第6図の検出装置で測定したところ、125μmであった。

搬送速度は1m/分とし、次いで陰極ロール1-1~1-17までの 各陰極ロールのモータ駆動設定において段階的にドロー比率設定を行い、 順次速度を上げ、張力を徐々に上げる方式とした。

第3図における調整タンク11にイオン交換水を入れて、100m1
/分となるようにポンプ14の設定を行い、受け皿10に供給した。このときの受け皿10中の電解液の導電率は0.02mS/cmであった。その結果、搬送前半部の陰極ロールの表面は、うっすらと銅系色になり、第6番目の陰極ロールから第14番目の陰極ロールには、銅の析出が観察され、陰極ロールが銅系色になった。初めの内は、搬送状況は安定していたが、銅が析出した陰極ロールが現れてからは、搬送状況は、徐々に不安になり、陰極ロール上でフィルムがグリップされ、フィルムに張りと撓みが発生し、液中の撹拌エアーのあおりを受けて、フィルムが蛇行し始め、陰極ロール上でシワが発生し、また、銅付きフィルムの剛性が大きいために折れシワの発生が観察された。

その後、めっき銅表面を観察したところ、フィルムの折れシワで製品にならず、一部シワのない場所でも、フィルム搬送方向に点々と長径100 μ m、高さ60 μ m大の異常突起がたくさん発生していた。異常な突起や凹みの個数は、表3に示す。

(3)回路パターンの形成

感光性液体レジストをコーティングし、 60μ mピッチ、すなわち、 銅導体線幅 30μ m、導体線間 30μ mの回路パターン1, 024本の マスクを使い紫外線露光と現像を行い、塩化第二鉄エッチング液で回路 パターンを形成した。その回路パターン50枚を150倍の実態顕微鏡 で観察し、欠け(10μ m以上の欠けは不合格で、それが1, 024本 中に1本以上あればその回路パターンを不合格とする)、および、断線に よるパターンの良否を判定した結果を表 5 に示す。収率 6 % で、ほとんど正常な回路パターンは得られなかった。

比較例2

10

15

20

この比較例は、銅付きフィルムをフレキシブル回路基板に応用したも 5 のである。

(1) 導電面付きフィルムの製作

実施例1と全く同様の導電面付きフィルムを作成した。

(2) めっき被膜の形成

得られたロール状のスパッタ膜付きフィルム12,000mを、3,000mのロール状体に4分割して、520mm×3,000mのロール状体の導電膜付きフィルムを4本準備し、そのうち1本を次に示すめっき装置に通してめっき被膜を形成した。

めっき装置として、第1図および第3図に示す装置を用いて、陽極2に銅を用い、第2図における一点鎖線内のユニット6aを16ユニットとしためっき回路およびめっき装置を構成した。8μmの厚さの銅のめっき被膜を有するフィルム4bを製造した。

陰極ロール1は、直径210mm、長さ800mm、肉厚10mmのSUS316の円管から形成された。陰極ロール1-1から液中ロール101-1を介して陰極ロール1-2まで、フィルム4aをパスさせたときのフィルムパス長は4mとした。パス長は、陰極ロール1の頂点から次の陰極ロールの頂点までのフィルム4aの長さを云う。従って、めっき部の全パス長は64mである。

フィルムの前処理条件、めっき条件、防錆処理条件は、表1に示す。 銅めっきの電流密度は、陰極ロール1と液中ロール101のパスの繰り 返し数が進むにつれて、徐々に電流密度が上昇するように設定した。第 1から第16ユニットの整流器3毎の電流設定条件は、表2に示す通り である。

15

20

25

液膜隙間 d は、第6図に示すように、レーザ変位計 4 4 で隙間 d の大きさを測定し、隙間 d が 5 0 μ m以下になるようにフィルム搬送張力 T の設定をした。フィルム張力設定は、第1図に示す S 字ラップの速度制御部 3 0 9 によって適度に張力をカットし、その後、順次ロールの回転速度にドローをかける方式で張力を設定した。陰極ロール 3 2 5 (張力検出ロール部)でロードセルによって自動で圧力検出を行い、張力が 3 2 0 N/mになるように、速度調整部 3 2 1 の駆動モータの速度でフィードバック制御した。

10 搬送速度は1m/分とし、次いで陰極ロール1-1~1-17までの 各陰極ロールのモータ駆動設定において段階的にドロー比率設定を行い、 順次速度を上げ、張力を徐々に上げる方式とした。フィルム4aの搬送 において、第3図における調整タンク11からの液体の供給は行なわな かった。

その結果、搬送前半部の陰極ロールの表面は、うっすらと銅系色になり、第6番目の陰極ロールから第14番目の陰極ロールには、銅の析出が観察され、陰極ロールが銅系色になった。初めの内は、搬送できたが、フィルム4aの張力が増大してくると、フィルム4aが緊張状態となり、この緊張状態が継続した後、フィルム4aに折れシワが発生し、その後、フィルム4aは、破断した。

以上の実施例および比較例、特に表3に示した製品の表面の欠陥の状態から明らかなように、本発明の方法で製造されためっき被膜付きフィルムは、非常に優れた外観品位を有する。本発明の方法で製造されためっき被膜付きフィルムは、ファインピッチの回路の形成を要求されるフレキシプル回路基板の製造に好ましく用いられる。

次に、本発明のめっき用陰極ロールを具体的実施例を用いて説明する。

めっき液に対して耐性のある材料の選定のために、材料のめっき液に 対する耐性を調査した。その結果、導電性と耐めっき液性の両方を合わ せ持つ材料を見つけることは、非常に困難であった。

表1に示すめっき液をスポイドで数m1滴下し、1日毎に、滴下しためっき液を拭き取り、耐性を目視で観察した。耐性のないものは、表面が変色した。2週間、この作業を続けた。2週間目の結果が、表6に示される。表6には、検討した材料とその特性値が示される。表6に示されるように、タングステンを主体とするもの、中でもクロムなどが所定割合で含有されているものが、優れた耐めっき液性を示した。

10 実施例3

この実施例は、銅付きフィルムをフレキシブル回路基板に応用したものである。

(1) 導電面付きフィルムの製作

減圧装置の中で、ロール状に巻き取ったフィルムを巻き出しながら、 15 処理し、その後フィルムを巻き取りロール状にする装置で、プラズマ処 理、ニッケルークロム層成膜、銅層成膜を行った。

厚さ25μm、幅520mm、長さ12,500mのポリイミドフィルム"カプトン"1 (米国デュポン社の登録商標)のロール状体を用意した。

上記フィルムの片面に、2m/分の速度でアルゴンガスのグロー放電プラズマ処理を実施した。処理は高電圧を印加した棒状の電極に対して2cmの距離でフィルムを搬送し、かつ接地電極となっている電極対をもつ内部電極方式のプラズマ装置を使用した。アルゴンガス圧力は2.5Pa、1次出力電圧2kV、高周波電源周波数110kHzの条件でフィルムを2m/分の速度で処理し、グロー放電プラズマ層を形成した。

処理されたフィルムの表面張力は、70dyne/cm以上で、接触角は43度であった。

次いで、アルゴンガス圧 2.6×10⁻² Paにて、クロム 20%、ニッケル 80%をターゲットとして用い、30nmのニッケルクロム層をDCマグネトロンスパッタ法を適用して形成した。その後、純度 99.9%の銅をターゲットとして用い、100nmの銅層をDCマグネトロンスパッタ法を適用して形成した。

上記フィルムから、スパッタ膜形成のための条件出しやリード部分を 除いて、12,000mのスパッタ膜付きフィルムを製造した。

10 (2)めっき被膜の形成

得られたロール状のスパッタ膜付きフィルム12,000mを、3,000mのロール状体に4分割して、520mm×3,000mのロール状体の導電膜付きフィルムを4本準備し、そのうち2本を次に示すめっき装置に通してめっき被膜を形成した。

15 めっき装置として、第1図に示す装置を用いて、陽極2に銅を用い、 第2図における一点鎖線内のユニット6 a を 1 6 ユニットとしためっき 回路およびめっき装置を構成した。 8 μ m の厚さの銅のめっき被膜を有 するフィルム 4 b を製造した。

陰極ロール1は、直径210mm、長さ1,500mm、肉厚10mmのSUS316の円管から形成された。この陰極ロール1の表面は、表3に示される表面処理番号8の溶射処理により表面処理された。表面処理の膜厚は200μm、表面粗さは、Rmaxで0.4μmとした。陰極ロール1の真円度は0.05mm以下、円筒度は0.08mm以下、円周方向の振れは0.08mm以下とした。表面のビッカース硬度Hvは、1,000であった。

陰極ロール1-1から液中ロール101-1を介して陰極ロール1-

2まで、フィルム4aをパスさせたときのフィルムパス長は4mとした。パス長は、陰極ロール1の頂点から次の陰極ロールの頂点までのフィルム4aの長さを云う。従って、めっき部の全パス長は、64mである。フィルムの前処理条件、めっき条件、防錆処理条件は、表1に示す。 銅めっきの電流密度は、陰極ロール1と液中ロール101のパスの繰り 短1数が進むにつれて、徐々に電流密度が上昇するように設定した。第

銅めっきの電流密度は、陰極ロール1と液中ロール101のパスの繰り返し数が進むにつれて、徐々に電流密度が上昇するように設定した。第1から第16ユニットの整流器3毎の電流設定条件は、表5に示す通りである。

10 表 5

整流器 No.	設定電流値	整流器 No.	設定電流值
3-1	20 A	3-10	350 A
3-2	32 A	3-11	370 A
3-3	50 A	3-12	396 A
3-4	64 A	3-13	416 A
3-5	90 A	3-14	430 A
3-6	136 A	3-15	436 A
3-7	190 A	3-16	440 A
3-8	270 A	合計	4,000 A
3-9	310 A		

表 6

表面	材料/表面処理法	ビッカース 硬度	耐めっき 液性
処理 番号	初 村/ 及 固 是 基 伍	使及 H v	权证
1	ハードクロム/めっき処理	2,000	E
2	NiP 系/めっき処理	1,700	E
3	TiN/PVD処理	2,000	E
4	CrN/PVD処理	2,100	E
5	TiCr/PVD処理	2,100	E
6	W、Co、Cr、C 系/溶射処理	1,000	C
7	Cr 系/溶射処理	950	С
8	W(70%)、Cr(19%)、Ni(5%)、C(6%)系/ 溶射処理	1,000	A
9	W(67%)、Cr(20%)、Ni(7%)、C(6%)系/ 溶射処理	1,150	В
1 0	W、Co、Cr、C系/溶射処理	1,270	D
1 1	Co、Mo、Cr、Si 系/溶射処理	750	D
1 2	浸炭処理	1,100	E
1 3	浸窒化処理	1,250	E
1 4	SUS316/焼き入れ処理	300	С

表中の符号-A:2ヶ月後変化なし、B:1ヶ月後少し変色、C:1週 5 間後少し変色、D:1日後少し変色、E:すぐに変色

フィルム張力設定は、第1図に示すS字ラップの速度制御部309によって適度に張力をカットし、その後、順次ロールの回転速度にドローをかける方式で張力を設定した。陰極ロール325(張力検出ロール部)でロードセルによって自動で圧力検出を行い、張力が240N/mにな

20

るように、速度調整部321の駆動モータの速度でフィードバック制御 した。

各陰極ロール1上の搬送張力は、第8図に示す簡易な張力測定器により測定した。第8図の張力測定器は、幅520mmのフィルムに作用する張力を測定することが出来る。

搬送速度は1m/分とし、次いで陰極ロール1-1~1-17の各陰極ロールのモータ駆動設定において段階的にドロー比率設定を行い、順次速度を上げ、張力を徐々に上げる方式とした。

各陰極ロール1に対して2本のフィルム4aを並行させて走行させた。

10 これら2本のフィルム4aの搬送状態は、非常に安定していた。

長さ3,000mのフィルム4aの2本を搬送させ、搬送開始から180分後の搬送位置をプロットしたグラフを第9図に示す。2本のフィルム4a-1、4a-2が搬送されている状態の第1図のめっき槽部303の平面図を第7図に示す。

15 第7図において、陰極ロール1の軸方向を縦軸(Y)、フィルム4aの 搬送方向(陰極ロール1の軸方向に直角の方向)を横軸(X)とした座 標が示されている。

第7図において、フィルム a - 1の搬送ラインをAライン、フィルム a - 2の搬送ラインをBラインとし、A: u、A: vは、Aラインのフィルム4a-1の端部の走行位置を示し、B: u、B: vは、Bラインのフィルム4a-2の端部の走行位置を示す。フィルム搬送位置は、第9図に示す通り、非常に安定していた。2本のフィルム4a-1、4a-2が搬送中に重なることもなく、それらの搬送は、非常に安定して行なわれた。

25 搬送張力Tを第8図に示す測定装置を用いて測定した結果を第13図 に示す。2本のフィルム4a-1、4a-2に対して、張力伝搬が円滑 に行なわれていることが、第13図からも判る。

その後、めっき銅表面を観察したところ、めっき表面の異常な突起や 凹みが少なく、表面品位の優れた銅めっき被膜付きフィルムが製造出来 たことが確認された。異常な突起や凹みの個数は、表7に示す。めっき 表面のキズも観察されず、めっき表面の表面粗さは、R m a x \overline{v} 1 μ m であった。

(3) 回路パターンの形成

感光性液体レジストをコーティングし、 60μ mピッチ、すなわち、 銅導体線幅 30μ m、導体線間 30μ mの回路パターン1,024本の マスクを使い紫外線露光と現像を行い、塩化第二鉄エッチング液で回路 パターンを形成した。その回路パターン50枚を150倍の実態顕微鏡 で観察し、欠け(10μ m以上の欠けは不合格で、それが1,024本 中に1本以上あればその回路パターンを不合格とする)、および、断線に よるパターンの良否を判定した結果を表8に示す。これにより収率100%の回路パターンが得られた。

表 7 520mm x 100mm 内の突起の個数

突起、窪みの最大径	実施例3	実施例4	比較例3	比較例4
$3 \sim 10 \ \mu \text{ m}$	10	15	> 100	
$11 \sim 50 \mu m$	8	6	83	
$51 \sim 100 \ \mu \text{ m}$	0	0	49	<u> </u>
101 μ m 以上	0	0	16	_

20 表 8

10

15

	実施例3	実施例4	比較例3	比較例4
良品数	50	50	2	
枚/50 枚	100 %	100 %	4%	

実施例4

一年経過後、これと全く同じ生産を行ったが、第10図、第14図、表7、表8に示すように、実施例1の結果とほぼ同じ結果が得られた。 比較例3

- 5 この比較例は、銅付きフィルムをフレキシブル回路基板に応用したも のである。
 - (1) 導電面付きフィルムの製作 実施例1と全く同様の導電面付きフィルムを作成した。
 - (2) めっき被膜の形成
- 10 得られたロール状のスパッタ膜付きフィルム12,000mを、3,000mのロール状体に4分割して、520mm×3,000mのロール状体の導電膜付きフィルムを4本準備し、そのうち2本を次に示すめっき装置に通してめっき被膜を形成した。

めっき装置として、第1図に示す装置を用いて、陽極2に銅を用い、 第2図における一点鎖線内のユニット6aを16ユニットとしためっき 回路およびめっき装置を構成した。8μmの厚さの銅のめっき被膜を有 するフィルム4bを製造した。

陰極ロール1は、直径210mm、長さ1,500mm、肉厚10mmのSUS316の円管から形成された。この陰極ロール1の表面を研磨し、研磨後の表面粗さをRmaxで0.6 μ mとした。陰極ロール1の真円度は0.05mm以下、円筒度は0.08mm以下、円周方向の振れは0.08mm以下とした。表面のビッカース硬度Hvは、70であった。

陰極ロール1-1から液中ロール101-1を介して陰極ロール1-25 2まで、フィルム4aをパスさせたときのフィルムパス長は4mとした。 パス長は、陰極ロール1の頂点から次の陰極ロールの頂点までのフィル

15

20

ム4 a の長さを云う。従って、めっき部の全パス長は、6 4 mである。 フィルムの前処理条件、めっき条件、防錆処理条件は、表1に示す。 銅めっきの電流密度は、陰極ロール1と液中ロール101のパスの繰り 返し数が進むにつれて、徐々に電流密度が上昇するように設定した。第 1から第16ユニットの整流器3毎の電流設定条件は、表5に示す通り である。

フィルム張力設定は、第1図に示すS字ラップの速度制御部309によって適度に張力をカットし、その後、順次ロールの回転速度にドローをかける方式で張力を設定した。陰極ロール325(張力検出ロール部)でロードセルによって自動で圧力検出を行い、張力が240N/mになるように、速度調整部321の駆動モータの速度でフィードバック制御した。各陰極ロール上の搬送張力は、陰極ロール1の両側にロードセル式のセンサーを設置し測定した。

搬送速度は1m/分とし、次いで陰極ロール1-1~1-17までの 各陰極ロールのモータ駆動設定において段階的にドロー比率設定を行い、 順次速度を上げ、張力を徐々に上げる方式とした。

この装置は、使用を開始してから1週間は、うまく運転できた。しかし、その後、徐々に陰極ロール1の表面に傷が現れ、これは目視でも判別できた。フィルム4aが陰極ロール1の表面にグリップされ、フィルム4aが陰極ロール1の表面にグリップされ、フィルム4aに張りと撓みが発生した。めっき液7中の撹拌エアーのあおりを受けて、フィルム4aが蛇行し始め、陰極ロール1上でフィルム4aにシワが発生した。また、銅付きフィルムの剛性が大きいために、折れシワの発生も観察された。

長さ3,000mのフィルム4aの2本を搬送させ、搬送開始から1 80分後の搬送位置をプロットしたグラフを第11図に示す。2本のフィルム4a-1、4a-2が搬送されている状態の第1図のめっき槽部

15

20

303の平面図を第7図に示す。2本のフィルム4a-1、4a-2の 走行状態は、第11図に見られる位置を結ぶ線が曲折している位置で、 蛇行を繰り返しており、搬送状態は、非常に不安定であった。

搬送張力 T を第8図に示す測定装置を用いて測定した結果を第15図に示す。2本のフィルム 4a-1、4a-2に対して、張力伝搬がランダムに変動していることが判る。

その後、めっき銅表面を観察したところ、フィルムの折れシワで製品にならず、一部シワのない場所でも、フィルム搬送方向に点々と長径100 μ m、高さ60 μ m大の異常突起がたくさん発生していた。異常な突起や凹みの個数は、表7に示す。また、表面品位を観察すると、陰極ロール1のキズと同様のキズが観察され、表面粗さもRmaxで20 μ mと非常に大きかった。これは、陰極ロール1のキズがフィルム4bの表面に反映しているためと思われる。

(3)回路パターンの形成

感光性液体レジストをコーティングし、 60μ mピッチ、すなわち、 銅導体線幅 30μ m、導体線間 30μ mの回路パターン1, 024本の マスクを使い紫外線露光と現像を行い、塩化第二鉄エッチング液で回路 パターンを形成した。その回路パターン50枚を150倍の実態顕微鏡 で観察し、欠け(10μ m以上の欠けは不合格で、それが1, 024本 中に1本以上あればその回路パターンを不合格とする)、および、断線に よるパターンの良否を判定した結果を表8に示す。収率4%で、ほとん ど正常な回路パターンは得られなかった。

比較例4

この比較例は、銅付きフィルムをフレキシブル回路基板に応用したも 25 のである。

比較例1とまったく同じ条件で、3ヶ月間の生産運転を繰り返し行な

ったが、この間に、2本のフィルム4a-1、4a-2の蛇行走行が激 しくなり、互いに重なり合う現象が生じた。それぞれのフィルムには、 シワや折れシワが発生し、正常な生産が出来ない状況に至った。

長さ3,000mのフィルム4a-1、4a-2を搬送させ、70分後の搬送位置をプロットしたグラフを第12図に示す。2本のフィルム4a-1、4a-2が搬送されている状態の第1図のめっき槽部303の平面図を第7図に示す。2本のフィルム4a-1、4a-2の走行状態は、第12図に見られる位置を結ぶ線が曲折している位置で、蛇行しており、重なり合っている位置で、2本のフィルムが重なり合っており、搬送状態は、非常に不安定であった。

搬送張力Tを第8図に示す測定装置を用いて測定した結果を第16図に示す。2本のフィルム4a-1、4a-2に対して、張力伝搬がランダムに変動していることが判る。陰極ロール1の表面を調べたところ、深さ0.5mm程のキズが無数存在していることが観察された。

表 8 に示した数値から明らかなように、本発明のめっき用陰極ロールを用い、本発明の製造方法で作成した銅めっき被膜付きフィルムは、めっき被膜の表面状態が極めて良好である。従って、この銅めっき被膜付きフィルムは、ファインピッチにて形成されるフレキシブル回路基板の作成に好適である。銅めっき被膜付きフィルムの生産性も優れている。

20

25

15

10

産業上の利用可能性

本発明によれば、フィルムの導電面に表面品位の優れためっき被膜が 形成され、品位の優れためっき被膜付きフイルムが、優れた生産性の基 に、製造される。製造されるためっき被膜付きフイルムは、回路基板の 基材として、特に、60μm以下のピッチで回路を形成するフレキシブ ル回路基板の基材として、好ましく用いられる。

請求の範囲

- 導電面を有するフィルムを搬送するフィルム搬送手段と、陰極ロールと、前記陰極ロールの前または/および後に配置され、めっき液および陽極が収容されためっき浴とを用い、前記フィルムを前記フィルム搬送手段により搬送しながら、前記フィルムの導電面を液膜を介して前記陰極ロールに電気的に接触させるとともに前記めっき浴中を通過させ、前記フィルムの導電面にめっき被膜を形成してなるめっき被膜付きフィルムの製造方法において、前記めっき被膜を形成する金属の還元電位を
 Eo、めっきのために前記陰極ロールに流す電流値をI、前記陰極ロールに前記液膜を介して電気的に接触している前記フィルムの導電面の面積をCs、前記陰極ロールと前記フィルムの導電面との隙間の厚さをd、および、該隙間に存在する前記液膜を形成している液の導電率をσとするとき、
- $E_o > [(I/C_s) \times d]/\sigma$ なる関係が満足されていることを特徴とするめっき被膜付きフィルムの 製造方法。
- 2. 前記隙間に存在する前記液膜を形成している液の導電率が、硫酸 20 を主体とする電解液の濃度により制御される請求の範囲第1項に記載の めっき被膜付きフィルムの製造方法。
 - 3. 前記隙間に存在する前記液膜を形成している液の導電率が、1m S/cm以上100mS/cm以下である請求の範囲第1項に記載のめっき被膜付きフィルムの製造方法。

20

- 4. 前記隙間の厚さdの値が、20μm以上500μm以下である請求の範囲第1項に記載のめっき被膜付きフィルムの製造方法。
- 5. 前記隙間の厚さdの値が、前記フィルムの搬送張力により制御される請求の範囲第4項に記載のめっき被膜付きフィルムの製造方法。
 - 6. 前記フィルムの搬送張力が、10N/m以上320N/m以下である請求の範囲第5項に記載のめっき被膜付きフィルムの製造方法。
- 10 7. 前記めっき被膜が、銅である請求の範囲第1項に記載のめっき被膜付きフィルムの製造方法。
 - 8. 前記フィルムが、ポリイミド樹脂、あるいは、ポリエステル樹脂からなる請求の範囲第1項に記載のめっき被膜付きフィルムの製造方法。
 - 9. 前記陰極ロールの表面に析出する前記めっき皮膜を形成する物質が、前記陰極ロールの表面に接して設けられたブレードおよび/または弾性体により除去される請求の範囲第1項に記載のめっき被膜付きフィルムの製造方法。
 - 10. 前記陰極ロール、前記プレード、および、前記弾性体の少なくとも一つに、連続的または間欠的に液体が供給される請求の範囲第9項に記載のめっき被膜付きフィルムの製造方法。
 - 25 11. 導電面を有するフィルムを搬送するフィルム搬送手段と、陰極 ロールと、前記陰極ロールの前または/および後に配置され、めっき液

25

および陽極が収容されためっき浴とを用い、前記フィルムを前記フィル ム搬送手段により搬送しながら、前記フィルムの導電面を液膜を介して 前記陰極ロールに電気的に接触させるとともに前記めっき浴中を通過さ せ、前記フィルムの導電面にめっき被膜を形成してなるめっき被膜付き フィルムの製造に用いられるめっき用陰極ロールにおいて、その表面の 粗さRmaxが、1μm以下であることを特徴とするめっき用陰極ロー ル。

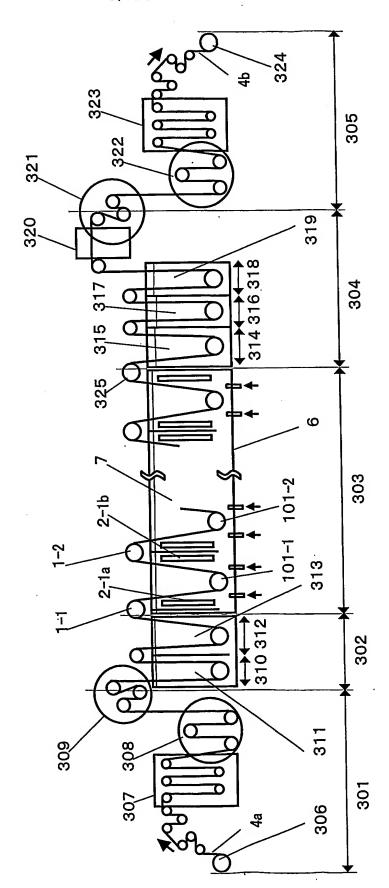
- 導電面を有するフィルムを搬送するフィルム搬送手段と、陰極 12. ロールと、前記陰極ロールの前または/および後に配置され、めっき液 および陽極が収容されためっき浴とを用い、前記フィルムを前記フィル ム搬送手段により搬送しながら、前記フィルムの導電面を液膜を介して 前記陰極ロールに電気的に接触させるとともに前記めっき浴中を通過さ せ、前記フィルムの導電面にめっき被膜を形成してなるめっき被膜付き フィルムの製造に用いられるめっき用陰極ロールにおいて、その表面の 15 ビッカース硬度が、200以上であることを特徴とするめっき用陰極ロ ール。
- タングステンを主体とする表面層が設けられている請求の範囲 第11あるいは12項に記載のめっき用陰極ロール。 20
 - タングステンを50%重量以上含有し、かつ、クロム、ニッケ 14. ル、および、炭素からなる群から選ばれた少なくとも一種の元素を含有 する表面層が設けられている請求の範囲第11あるいは12項に記載の めっき用陰極ロール。

15. タングステンを60乃至80重量%、クロムを15乃至25重量%、ニッケルを1乃至10重量%、および、炭素を1乃至10重量%を含有する表面層が設けられている請求の範囲第11あるいは12項に記載のめっき用陰極ロール。

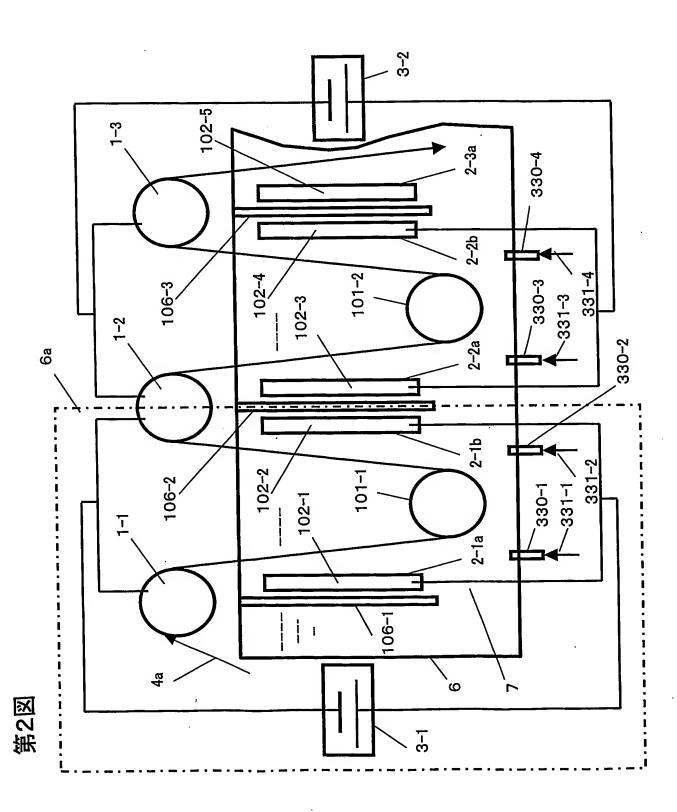
5

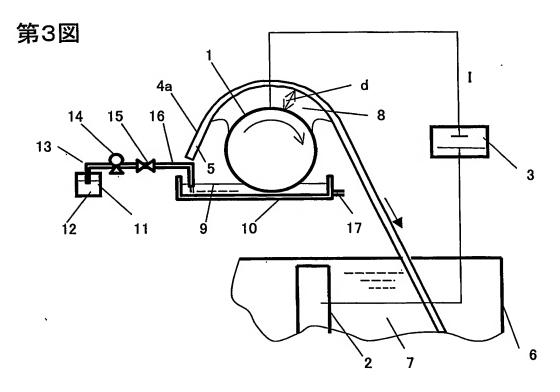
- 16. 溶射法により表面処理されている請求の範囲第11あるいは12項に記載のめっき用陰極ロール。
- 17. 前記溶射法が、爆発溶射法である請求の範囲第16項に記載の 10 めっき用陰極ロール。
 - 18. 前記溶射法により表面処理され形成された溶射膜の気孔率が、 2%以下である請求の範囲第16項に記載のめっき用陰極ロール。
- 15 19. 導電面を有するフィルムを搬送するフィルム搬送手段と、陰極ロールと、前記陰極ロールの前または/および後に配置され、めっき液および陽極が収容されためっき浴とを用い、前記フィルムを前記フィルム搬送手段により搬送しながら、前記フィルムの導電面を液膜を介して前記陰極ロールに電気的に接触させるとともに前記めっき浴中を通過させ、前記マイルムの導電面にめっき被膜を形成してなるめっき被膜付きフィルムの製造方法。
 20 せ、前記フィルムの導電面にめっき被膜を形成してなるめっき被膜付きフィルムの製造方法。
- 20. めっき被膜を有するフィルムに回路パターンを形成することに より回路基板を製造する回路基板の製造方法において、前記めっき被膜

を有するフィルムが、請求の範囲第1乃至10項のいずれか、あるいは、 請求の範囲第19項に記載のめっき被膜付きフィルムの製造方法により 製造されためっき被膜付きフィルムであることを特徴とする回路基板の 製造方法。

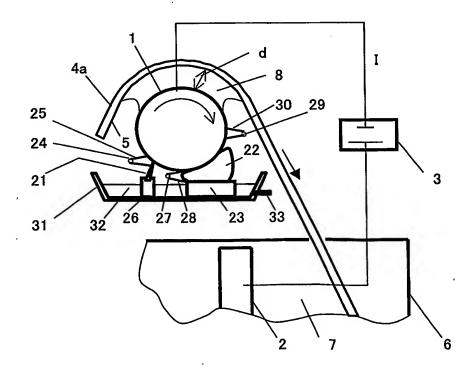


第1図

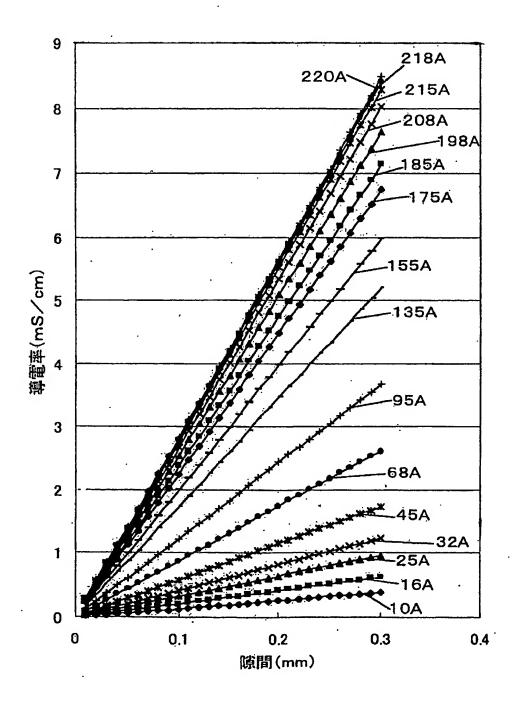


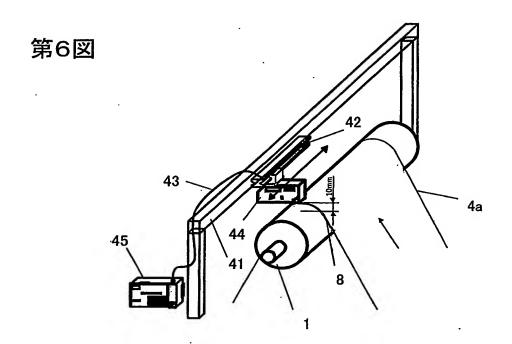


第4図

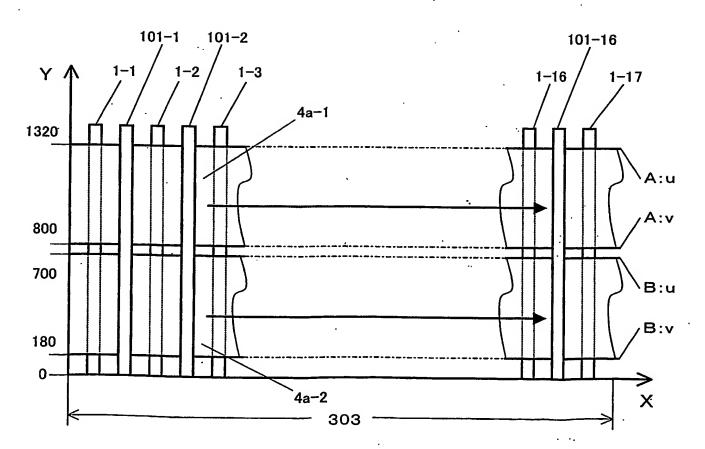


第5図

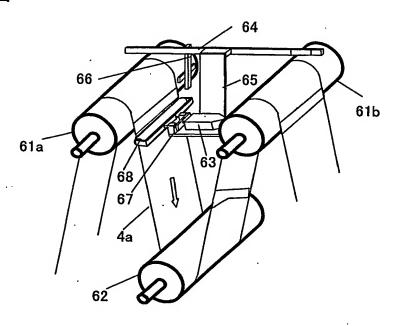




第7図

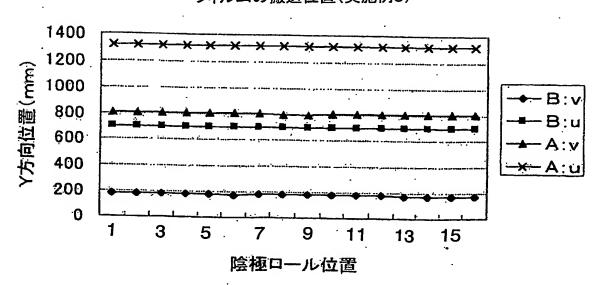


第8図



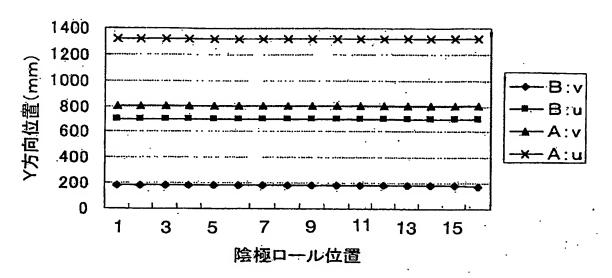
第9図

フィルムの搬送位置(実施例3)



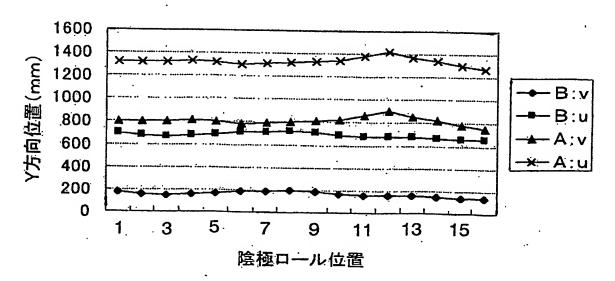
第10図

フィルムの搬送位置(実施例4)



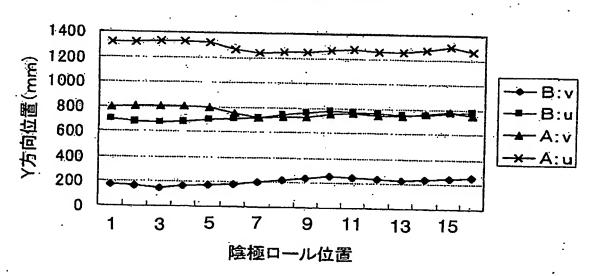
第11図

フィルムの搬送位置(比較例3)



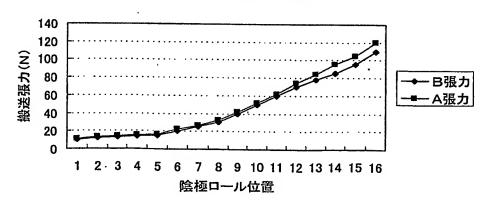
第12図

フィルムの搬送位置(比較例4)



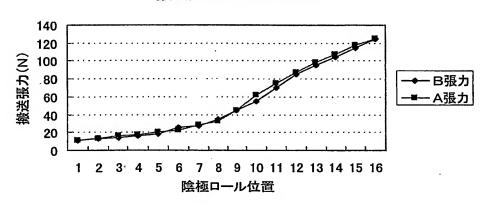
第13図

搬送張力測定結果(実施例3)



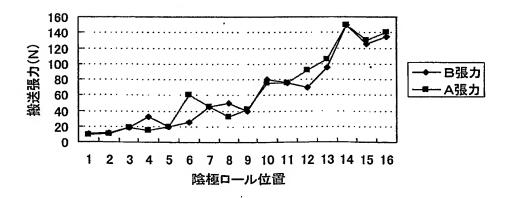
第14図

搬送張力測定結果(実施例4)



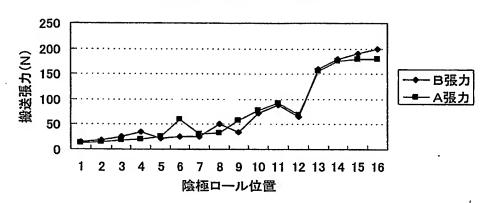
第15図

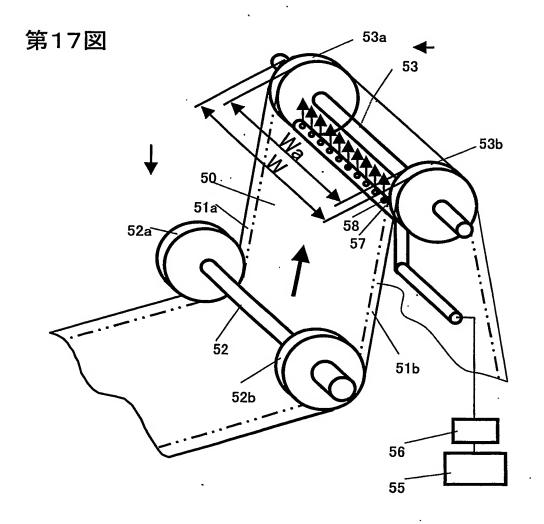
搬送張力測定結果(比較例3)



第16図

搬送張力測定結果(比較例4)







•

International application No.

PCT/JP03/07537

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C25D21/00				
According to International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC			
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed	by classification symbols)			
Int.Cl ⁷ C25D21/00				
Documentation searched other than minimum documentation to the	e extent that such documents are included	in the fields searched		
Jitsuyo Shinan Koho 1926—1996 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971—2003	Toroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho	0 1994–2003 0 1996–2003		
Electronic data base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category* Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.		
A JP 7-62599 A (Fuji Photo Fil 07 March, 1995 (07.03.95), (Family: none)	m Co., Ltd.),	1-20		
	·			
	•			
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not 	"T" later document published after the into priority date and not in conflict with t			
considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing	understand the principle or theory und "X" document of particular relevance; the	erlying the invention		
date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone	ered to involve an inventive		
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other				
means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "Combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family				
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer				
Facsimile No. Telephone No.				

	HINING TA H		
Α.	発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
	Int. Cl' C25D 21/00	·	
В.	調査を行った分野		
	行った最小限資料(国際特許分類(IPC))		
	Int. C17 C25D 21/00		
最小限	日 日本国実用新案公報 1926—1996年 日本国公開実用新案公報 1971—2003年 日本国登録実用新案公報 1994—2003年 日本国実用新案登録公報 1996—2003年		
国際調	i査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
c.	関連すると認められる文献		
引用文			関連する
	オリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると		請求の範囲の番号
A	A. JP 7-62599 A (富 1995.03.07 (ファミリー		1-20
	,		
	C欄の続きにも文献が列挙されている。 	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
[A] [E]	旧文献のカテゴリー 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す) 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表出願と矛盾するものではなく、の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、の新規性又は進歩性がないと考 「Y」特に関連のある文献であって、上の文献との、当業者にとってよって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献	発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際記	周査を完了した日 16.09.03	国際調査報告の発送日 30	0.09. 03
国際記	周査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 鈴 木 正 紀 (五) 電話番号 03-3581-1101	内線 3423

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.